

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60427

Troisième édition
Third edition
2000-04

**Essais synthétiques des disjoncteurs
à courant alternatif à haute tension**

**Synthetic testing of high-voltage alternating
current circuit-breakers**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60427:2000

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- **«Site web» de la CEI***
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement
(Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60427

Troisième édition
Third edition
2000-04

**Essais synthétiques des disjoncteurs
à courant alternatif à haute tension**

**Synthetic testing of high-voltage alternating
current circuit-breakers**

© IEC 2000 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE XB

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	6
INTRODUCTION	10
Articles	
1 Domaine d'application	12
2 Références normatives	12
3 Définitions.....	12
4 Techniques et méthodes d'essais synthétiques – Essais de coupure de courant de court-circuit.....	16
4.1 Principes fondamentaux et exigences générales pour les méthodes d'essais synthétiques de coupure	16
4.2 Exigences spécifiques de chaque circuit d'essais synthétiques pour les essais de coupure	22
5 Essais d'établissement en court-circuit.....	26
5.1 Principes fondamentaux et exigences générales pour les essais synthétiques d'établissement en court-circuit.....	26
5.2 Circuit d'essais synthétiques pour essais de fermeture et exigences spécifiques s'y rapportant.....	28
6 Exigences particulières pour les essais synthétiques d'établissement et de coupure relatives aux prescriptions des paragraphes 6.102 à 6.111 de la CEI 60056	30
 Annexe AA (informative) Déformation du courant	 60
Annexe BB (informative) Méthodes d'injection de courant	90
Annexe CC (informative) Méthodes d'injection de tension	100
Annexe DD (informative) Circuit de Skeats (ou par transformateur).....	106
Annexe EE (normative) Indications à donner et résultats à enregistrer lors d'essais synthétiques.....	112
Annexe FF (informative) Procédures d'essais particulières pour les disjoncteurs équipés de résistances de coupure parallèles	114
Annexe GG (normative) Méthodes synthétiques pour l'établissement et la coupure de courant capacitif	120
Annexe HH (informative) Méthodes de réallumage pour la prolongation de l'arc	138
 Figure 1 – Processus d'interruption; périodes principales	 48
Figure 2 – Exemple de tension de rétablissement.....	50
Figure 3 – Impédance d'onde équivalente dans le circuit de tension du schéma à injection de courant.....	52
Figure 4 – Processus de fermeture; périodes principales.....	54
Figure 5 – Durée maximale permise de pré-arc pour qu'un essai de fermeture à tension réduite soit valide	56
Figure 6 – Circuit synthétique de fermeture et formes d'ondes	58
Figure AA.1a – Circuit direct, schéma simplifié.....	74
Figure AA.1b – Courant de court-circuit présumé	74
Figure AA.1c – Courant déformant	74

CONTENTS

	Page
FOREWORD	7
INTRODUCTION	11
Clause	
1 Scope	13
2 Normative references.....	13
3 Definitions.....	13
4 Synthetic testing techniques and methods – Short-circuit breaking tests	17
4.1 Basic principles and general requirements for synthetic breaking test methods.....	17
4.2 Synthetic test circuits and related specific requirements for breaking tests	23
5 Short-circuit making tests.....	27
5.1 Basic principles and general requirements for synthetic making test methods.....	27
5.2 Synthetic test circuit and related specific requirements for making tests	29
6 Specific requirements for synthetic tests for making and breaking performance related to the requirements of subclauses 6.102 to 6.111 inclusive of IEC 60056.....	31
Annex AA (informative) Current distortion.....	61
Annex BB (informative) Current injection methods.....	91
Annex CC (informative) Voltage injection methods	101
Annex DD (informative) Duplicate circuit (transformer or Skeats circuit)	107
Annex EE (normative) Information to be given and results to be recorded for synthetic tests	113
Annex FF (informative) Special procedures for testing circuit-breakers having parallel breaking resistors	115
Annex GG (normative) Synthetic methods for capacitive-current switching	121
Annex HH (informative) Reignition methods to prolong arcing	139
Figure 1 – Interrupting process; basic time intervals.....	49
Figure 2 – Example of recovery voltage.....	51
Figure 3 – Equivalent surge impedance within the voltage circuit of current injection scheme	53
Figure 4 – Making process; basic time intervals	55
Figure 5 – Maximum allowable pre-arcing time for valid making test at reduced voltage	57
Figure 6 – Synthetic make circuit and waveforms	59
Figure AA.1a – Direct circuit, simplified diagram	75
Figure AA.1b – Prospective short-circuit current.....	75
Figure AA.1c – Distortion current.....	75

Figure AA.1d – Courant déformant	76
Figure AA.2a – Schéma de circuit simplifié.....	76
Figure AA.2b – Caractéristiques du courant et de la tension d'arc pour courant symétrique..	78
Figure AA.2c – Caractéristiques de courant et de tension d'arc pour courant asymétrique....	80
Figures AA.3a à AA.3d – Réduction de l'amplitude et de la durée de la dernière alternance.	80
Figure BB.1 – Circuit type à injection de courant où le circuit de tension est en parallèle avec le disjoncteur en essai	94
Figure BB.2 – Séquence de l'injection du courant dans le circuit de la figure BB.1	94
Figure BB.3 – Circuit type à injection de courant où le circuit de tension est en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire	96
Figure BB.4 – Séquence de l'injection dans le circuit de la figure BB.3.....	96
Figure BB.5 – Exemples de détermination de la période de changement significatif de la tension d'arc à partir d'oscillogrammes	98
Figure CC.1 – Schéma caractéristique de l'injection de tension avec le circuit de tension en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire (schéma simplifié)	102
Figure CC.2 – Formes d'onde (TTR) obtenues dans un circuit d'injection de tension avec la source de tension en parallèle avec le disjoncteur auxiliaire.....	104
Figure DD.1 – Circuit de Skeats ou par transformateur.....	110
Figure DD.2 – Circuit de Skeats ou par transformateur avec déclenchement.....	110
Figure GG.1 – Schéma d'essais synthétiques (dit parallèle)	126
Figure GG.2 – Schéma d'essais synthétiques avec circuit de courant inductif et la possibilité de régler le saut de tension.....	128
Figure GG.3 – Circuit synthétique d'injection de tension simulant le saut de tension	130
Figure GG.4 – Circuit synthétique à injection de courant	132
Figure GG.5 – Circuit d'essai synthétique (dit série) pour appliquer aux deux bornes du disjoncteur en essai les composantes réelles de la tension de rétablissement.....	134
Figure GG.6 – Schéma d'essais synthétique pour la fermeture	136
Figure HH.1 – Schéma type du circuit de réallumage servant à prolonger la durée d'arc	142
Figure HH.2 – Circuits combinés d'injection de courant et de Skeats.....	142
Figure HH.3 – Formes d'ondes typiques obtenues sur un essai asymétrique en utilisant le circuit de la figure HH.2	144

	Page
Figure AA.1d – Distortion current	77
Figure AA.2a – Simplified circuit diagram	77
Figure AA.2b – Current and arc-voltage characteristics for symmetrical current	79
Figure AA.2c – Current and arc-voltage characteristics for asymmetrical current.....	81
Figures AA.3a to AA.3d – Reduction of amplitude and duration of final current loop of arcing	83
Figure BB.1 – Typical current injection circuit with voltage circuit in parallel with the test circuit-breaker	95
Figure BB.2 – Injection timing for current injection scheme with circuit BB.1.....	95
Figure BB.3 – Typical current injection circuit with voltage circuit in parallel with the auxiliary circuit-breaker	97
Figure BB.4 – Injection timing for current injection scheme with circuit BB.3.....	97
Figure BB.5 – Examples of the determination of the interval of significant change of arc-voltage from the oscillograms.....	99
Figure CC.1 – Typical voltage injection circuit diagram with voltage circuit in parallel with the auxiliary circuit-breaker (simplified diagram)	103
Figure CC.2 – TRV waveshapes in a voltage injection circuit with the voltage circuit in parallel with the auxiliary circuit-breaker	105
Figure DD.1 – Transformer or Skeats circuit.....	111
Figure DD.2 – Triggered transformer or Skeats circuit	111
Figure GG.1 – Synthetic testing scheme (parallel mode)	127
Figure GG.2 – Synthetic testing scheme with an inductive current circuit and with facility to adjust a voltage jump	129
Figure GG.3 – Synthetic voltage injection circuit providing a voltage jump.....	131
Figure GG.4 – Synthetic current injection scheme	133
Figure GG.5 – Synthetic test circuit (serial mode) to apply to both sides of the test breaker the normal system recovery voltage	135
Figure GG.6 – Synthetic testing scheme for making	137
Figure HH.1 – Typical reignition circuit diagram for prolonging arc-duration	143
Figure HH.2 – Combined Skeats and current injection circuits.....	143
Figure HH.3 – Typical waveforms obtained on an asymmetrical test using the circuit in figure HH.2.....	145

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS SYNTHÉTIQUES DES DISJONCTEURS À COURANT ALTERNATIF À HAUTE TENSION

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60427 a été établie par le sous-comité 17A: Appareillage à haute tension, du comité d'études 17 de la CEI: Appareillage.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 1989, l'amendement 1 (1992), l'amendement 2 (1995). Cette troisième édition constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu de la deuxième édition, de l'amendement 1, de l'amendement 2 et des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
17A/559/FDIS	17A/565/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication n'a pas été rédigée en parfaite conformité avec les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Cette publication doit être lue conjointement avec la CEI 60056 (1987). La numérotation des paragraphes de l'article 6 reprend celle de la CEI 60056. Les annexes et leurs figures sont appelées AA, BB, etc.

Les annexes EE et GG font partie intégrante de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**SYNTHETIC TESTING OF HIGH-VOLTAGE ALTERNATING
CURRENT CIRCUIT-BREAKERS**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60427 has been prepared by subcommittee 17A: High voltage switchgear and controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 1989, amendment 1 (1992), amendment 2 (1995). This third edition constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the second edition, amendment 1, amendment 2 and the following documents:

FDIS	Report on voting
17A/559/FDIS	17A/565/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has not been drafted in complete accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

This publication shall be read in conjunction with IEC 60056 (1987). The numbering of the subclauses of clause 6 is the same as in IEC 60056. The annexes and their figures are named AA, BB, etc.

Annexes EE and GG form an integral part of this standard.

Les annexes AA, BB, CC, DD, FF et HH sont données uniquement à titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005-01-01.
A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Annexes AA, BB, CC, DD, FF and HH are for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2005-01-01. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

Au cours des dernières décennies, les connaissances sur les techniques et les méthodes d'essais synthétiques ont progressé. Il a été démontré que l'essai synthétique était un moyen économique et techniquement valable pour essayer les disjoncteurs à courant alternatif à haute tension selon les spécifications de la CEI 60056.

C'est pourquoi il a été décidé de considérer les méthodes d'essais synthétiques, après une révision complète de la première édition de la CEI 60427, comme équivalentes aux méthodes d'essais directs.

INTRODUCTION

During the past few decades experience has been gained with synthetic testing techniques and methods. It has been proven that synthetic testing is an economical and technically correct way to test high-voltage a.c. circuit-breakers according to the requirements of IEC 60056.

This is why it was decided to include synthetic testing methods, after a thorough revision of the first edition of IEC 60427, as equivalent to the direct test methods.

ESSAIS SYNTHÉTIQUES DES DISJONCTEURS À COURANT ALTERNATIF À HAUTE TENSION

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale s'applique aux disjoncteurs à courant alternatif définis dans le domaine d'application de la CEI 60056. Elle donne les règles générales d'essais de ces disjoncteurs pour les essais d'établissement et de coupure décrits aux 6.102 à 6.111 de la CEI 60056, à l'aide de méthodes d'essais synthétiques.

NOTE Les circuits pour les séquences d'essais décrites au 6.111 ne sont pas encore normalisés. Néanmoins, les méthodes existantes sont indiquées à l'annexe GG.

Les méthodes et techniques décrites sont celles d'usage courant. Le but de cette norme est d'établir des critères pour les essais synthétiques et pour l'évaluation correcte des résultats. Ces critères établissent la validité de la méthode d'essai sans limiter l'invention de nouveaux circuits d'essais.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60050(441):1984, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 441: Appareillage et fusibles*

CEI 60056:1987, *Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension*

CEI 61633:1995, *Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension – Guide pour la procédure d'essai d'établissement et de coupure de courants de court-circuit et de courants de charge pour les disjoncteurs sans enveloppe métallique et à cuve mise à la terre*

3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale les définitions de la CEI 60056 et les définitions suivantes s'appliquent:

3.1

essai direct

essai dans lequel la tension appliquée, le courant, la tension de rétablissement, transitoire et à fréquence industrielle, sont tous obtenus à l'aide d'un seul circuit de puissance. Cette source peut être un réseau ou des alternateurs spéciaux comme ceux qui sont utilisés dans les stations d'essais de court-circuit ou une combinaison des deux

SYNTHETIC TESTING OF HIGH-VOLTAGE ALTERNATING CURRENT CIRCUIT-BREAKERS

1 Scope

This International Standard applies to a.c. circuit-breakers within the scope of IEC 60056. It provides the general rules for testing a.c. circuit-breakers, for making and breaking capacities over the range of test-duties described in 6.102 to 6.111 of IEC 60056, by synthetic methods.

NOTE Circuits for the test duties described in 6.111 have not yet been standardized. However, present methods are given in annex GG.

The methods and techniques described are those in general use. The purpose of this standard is to establish criteria for synthetic testing and for the proper evaluation of results. Such criteria will establish the validity of the test method without imposing restraints on innovation of test circuitry.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60050(441):1984, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses*

IEC 60056:1987, *High-voltage alternating current circuit-breakers*

IEC 61633:1995, *High-voltage alternating current circuit-breakers – Guide for short-circuit and switching test procedures for metal-enclosed and dead tank circuit-breakers*

3 Definitions

For the purposes of this International Standard the definitions of IEC 60056 and the following definitions apply:

3.1

direct test

a test in which the applied voltage, the current and the transient and power-frequency recovery voltages are all obtained from a circuit having a single-power source, which may be a power system or special alternators as used in short-circuit testing stations or a combination of both

3.2

essai synthétique

essai dans lequel la totalité du courant ou la plus grande partie de celui-ci est obtenue à partir d'une source (circuit de courant) et dans lequel la tension appliquée et/ou les tensions de rétablissement (transitoire et à fréquence industrielle) sont obtenues en totalité ou en partie à partir d'une ou de plusieurs sources séparées (circuit de tension)

3.3

disjoncteur en essai

disjoncteur soumis aux essais (voir 6.102.2 de la CEI 60056)

3.4

disjoncteur(s) auxiliaire(s)

disjoncteur introduit dans le circuit d'essais synthétiques et utilisé pour séparer ou relier les différents circuits au disjoncteur en essai

3.5

circuit de courant

partie du circuit d'essais synthétiques fournissant la plus grande part du courant à fréquence industrielle ou sa totalité

3.6

circuit de tension

partie du circuit d'essais synthétiques fournissant la plus grande part de la tension d'essai ou sa totalité

3.7

courant présumé (d'un circuit pour un disjoncteur donné)

courant qui circulerait dans le circuit si chaque pôle du disjoncteur en essai et du disjoncteur auxiliaire était remplacé par un conducteur d'impédance négligeable [VEI 441-17-01, modifiée]

3.8

courant réel

courant circulant dans le disjoncteur en essai (courant présumé modifié par les tensions d'arc des disjoncteurs en essai et auxiliaire)

3.9

courant déformant

courant calculé égal à la différence entre le courant présumé et le courant réel

3.10

courant post-arc

courant qui circule dans l'espace entre les contacts d'arc d'un disjoncteur immédiatement après que le courant et la tension d'arc sont devenus nuls et que la tension transitoire de rétablissement a commencé à croître

3.11

méthode par injection de courant

méthode d'essais synthétiques dans laquelle la source de tension est appliquée au disjoncteur en essai avant le zéro de courant à fréquence industrielle

3.12

courant injecté

courant fourni par le circuit de tension d'un circuit à injection de courant au moment où cette source est reliée au disjoncteur en essai

3.2**synthetic test**

a test in which all of the current, or a major portion of it, is obtained from one source (current circuit), and in which the applied voltage and/or the recovery voltages (transient and power-frequency) are obtained wholly or in part from one or more separate sources (voltage circuits)

3.3**test circuit-breaker**

the circuit-breaker under test (see 6.102.2 of IEC 60056)

3.4**auxiliary circuit-breaker(s)**

the circuit-breaker(s) forming part of a synthetic test circuit used to put the test circuit-breaker into the required relation with various circuits

3.5**current circuit**

that part of the synthetic test circuit from which all or the major part of the power-frequency current is obtained

3.6**voltage circuit**

that part of the synthetic test circuit from which all or the major part of the test voltage is obtained

3.7**prospective current (of a circuit and with respect to a circuit-breaker)**

the current that would flow in the circuit if each pole of the test and auxiliary circuit-breakers were replaced by a conductor of negligible impedance [IEV 441-17-01, modified]

3.8**actual current**

the current through the test circuit-breaker (prospective current modified by the arc-voltage of the test and auxiliary circuit-breakers)

3.9**distortion current**

a calculated current equal to the difference between the prospective current and the actual current

3.10**post-arc current**

the current which flows through the arc-gap of a circuit-breaker immediately after the current and arc-voltage have fallen to zero and the transient recovery voltage has begun to rise

3.11**current-injection method**

a synthetic test method in which the voltage circuit is applied to the test circuit-breaker before power-frequency current-zero

3.12**injected current**

the current supplied by the voltage circuit of a current injection circuit when it is connected to the circuit-breaker under test

3.13

méthode par injection de tension

méthode d'essais synthétiques dans laquelle la source de tension est appliquée au disjoncteur en essai après le zéro de courant à fréquence industrielle

3.14

conditions du réseau de référence

conditions d'un réseau électrique ayant les paramètres constitutifs dont les valeurs spécifiées et les valeurs d'essais de la CEI 60056 sont dérivées

4 Techniques et méthodes d'essais synthétiques – Essais de coupure de courant de court-circuit

4.1 Principes fondamentaux et exigences générales pour les méthodes d'essais synthétiques de coupure

Toute méthode d'essai synthétique retenue doit contraindre le disjoncteur en essai de manière adéquate. L'adéquation est généralement établie dès que la méthode satisfait aux exigences exposées dans les paragraphes suivants.

Périodes principales

Le disjoncteur a deux positions: fermé et ouvert. Fermé, il conduit le plein courant avec une chute de tension négligeable entre ses contacts. Ouvert, il ne laisse passer qu'un courant négligeable mais avec la pleine tension entre ses contacts. Cela définit les deux contraintes principales, la contrainte en courant et la contrainte en tension, qui sont séparées dans le temps.

Si on observe plus précisément les contraintes en tension et courant pendant le processus de coupure (figure 1), trois périodes principales peuvent être distinguées:

- La période fort courant
Cette période est définie par le temps entre la séparation des contacts et le début du changement significatif de la tension d'arc. La période fort courant précède les périodes d'interaction et de contrainte diélectrique.
- La période d'interaction
Cette période est définie par le temps séparant le début du changement significatif de la tension d'arc avant le zéro de courant, de la disparition du courant dans le disjoncteur, y compris, s'il existe, le courant post-arc (voir aussi annexe BB.2).
- La période de contrainte diélectrique
Cette période est définie par le temps séparant la disparition du courant dans le disjoncteur en essai, y compris le courant post-arc, s'il existe, de la fin de l'essai.

4.1.1 Période fort courant

Pendant cette période, le disjoncteur en essai doit être contraint par le circuit de manière telle que les conditions initiales de la période d'interaction, avec des tolérances à préciser, soient les mêmes que celles apparaissant dans les conditions du réseau de référence.

Dans les circuits d'essais synthétiques, le rapport entre la tension à fréquence industrielle du circuit de courant et la tension d'arc est faible comparé à ce rapport lors d'essais dans les conditions du réseau de référence, pour deux raisons:

- cette tension d'alimentation est une fraction de la tension du réseau;
- les tensions d'arc des disjoncteurs en essai et auxiliaire s'ajoutent.

3.13**voltage-injection method**

a synthetic test method in which the voltage circuit is applied to the test circuit-breaker after power-frequency current-zero

3.14**reference system conditions**

the conditions of an electrical system having the parameters from which the rated and test values of IEC 60056 are derived

4 Synthetic testing techniques and methods – Short-circuit breaking tests**4.1 Basic principles and general requirements for synthetic breaking test methods**

Any particular synthetic method chosen for testing shall adequately stress the test circuit-breaker. Generally, the adequacy is established when the test method meets the requirements set forth in the following subclauses.

Basic intervals

A circuit-breaker has two basic positions: closed and open. In the closed position a circuit-breaker conducts full current with negligible voltage drop across its contacts. In the open position it conducts negligible current but with full voltage across the contacts. This defines the two main stresses, the current stress and the voltage stress, which are separated in time.

If closer attention is paid to the voltage and current stresses during the interrupting process (figure 1), three main intervals can be recognized:

- High-current interval

The high-current interval is the time from contact separation to the start of the significant change in arc-voltage. The high-current interval precedes the interaction and high-voltage intervals.

- Interaction interval

The interaction interval is the time from the start of the significant change in arc-voltage prior to current-zero to the time when the current including the post-arc current, if any, ceases to flow through the test circuit-breaker. (See also annex BB.2).

- High-voltage interval

The high-voltage interval is the time from the moment when the current including the post-arc current, if any, ceases to flow through the test circuit-breaker to the end of the test.

4.1.1 High-current interval

During this interval the test circuit-breaker shall be stressed by the test circuit in such a way that the starting conditions for the interaction interval, within tolerances to be specified, are the same as under reference system conditions.

In synthetic test circuits the ratio of the power-frequency voltage of the current circuit to the arc-voltage is low in comparison with tests at reference system conditions due to:

- the voltage of the current circuit being a fraction of the system voltage;
- the fact that the arc-voltages of the test circuit-breaker and of the auxiliary circuit-breaker are added.

Il en résulte que la durée de l'onde de courant et sa valeur à la crête en sont réduites. Cette déformation est expliquée dans l'annexe AA.

L'étude de l'énergie d'arc dégagée dans le disjoncteur en essai conduit à fixer les tolérances pour limiter l'influence de cette déformation sur deux grandeurs caractéristiques de la forme du courant, à savoir la valeur crête de l'onde et la durée de cette onde (voir annexe AA).

Les tolérances sur l'amplitude et la fréquence du courant présumé à couper, comme indiqué en 6.103.2 et 6.104.3 de la CEI 60056, ne doivent pas être dépassées par le courant réel circulant dans le disjoncteur en essai. Les conditions suivantes devront donc être remplies:

- l'amplitude de la dernière alternance du courant réel dans le disjoncteur en essai doit satisfaire aux prescriptions imposées par le 6.104.3 de la CEI 60056, pour le courant présumé. L'amplitude de la dernière alternance du courant réel d'essai dans le circuit monophasé ne sera pas inférieure à 90 % de la valeur spécifiée;
- la durée de la dernière alternance du courant d'essai réel à fréquence industrielle ne doit pas être inférieure à 90 % de la durée de l'alternance qui serait obtenue avec la fréquence assignée pour le disjoncteur prenant en compte, si nécessaire, l'effet de la composante continue spécifiée;
- si des essais synthétiques sont entrepris sur des disjoncteurs dont la tension d'arc modifierait très sensiblement le courant en réseau, l'influence de cette tension d'arc sur l'amplitude et la durée de l'alternance peut être prise en considération lorsqu'on définit les tolérances ci-dessus.

La procédure détaillée d'estimation de ces corrections est donnée dans l'annexe AA avec des exemples d'établissement des tolérances.

Pour respecter ces tolérances, une augmentation du courant d'essai est permise, soit en augmentant la tension, soit en réduisant la réactance de la source de courant, soit en lui superposant une composante continue, ou encore en réduisant la fréquence industrielle. Dans ce but, les tolérances spécifiées pour la composante continue et la fréquence industrielle peuvent être dépassées avec l'accord du constructeur.

4.1.2 Période d'interaction

Pendant la période d'interaction, la contrainte provoquée par le courant de court-circuit se change en contrainte à haute tension et, selon le comportement du disjoncteur, les tensions et courant du circuit peuvent être fortement affectés. Quand le courant décroît vers zéro, la tension d'arc peut augmenter en chargeant une capacité parallèle et déformer le courant traversant l'arc. Après le zéro de courant, la conductivité post-arc peut introduire un amortissement supplémentaire de la tension transitoire de rétablissement et, par là, modifier la tension entre les contacts du disjoncteur et l'énergie fournie à l'espace ionisé entre les contacts. L'interaction entre circuit et disjoncteur immédiatement avant et après le zéro de courant (c'est-à-dire pendant la période d'interaction) est d'une extrême importance pour le phénomène de coupure.

Pendant cette période d'interaction, les formes d'ondes de courant et de tension doivent être les mêmes en essais synthétiques que dans le réseau de référence (3.1.4), en prenant en compte les modifications possibles de ces courant et tension par rapport aux valeurs présumées, dues à l'interaction circuit-disjoncteur.

La période d'interaction représente la période critique pour une défaillance de coupure du disjoncteur en mode thermique. Par conséquent, il est d'une extrême importance que la forme et l'amplitude de la tension transitoire de rétablissement (TTR) présumée correspondent à celles associées au courant présumé de la séquence d'essais concernée.

As a result the duration of the current loop and the peak value of the current will be reduced. This distortion of the current is outlined in annex AA.

Considerations with respect to the arc-energy released in the test circuit-breaker lead to a maximum permissible influence in terms of tolerances on two characteristic values of the shape of the current, i.e. current-peak value and current-loop duration (see annex AA).

The tolerance on the amplitude and the power frequency of the prospective breaking current, as given in 6.103.2 and 6.104.3 of IEC 60056, shall not be exceeded by the actual current through the test circuit-breaker. Therefore the following conditions shall be met:

- the actual current amplitude during the last loop in the test circuit-breaker shall comply with the requirements for the prospective current stated in 6.104.3 of IEC 60056. The amplitude of the final loop of the actual test current in a single phase circuit shall be not less than 90 % of the value specified;
- the duration of the final loop of the actual power-frequency test current shall be not less than 90 % of the loop duration given by the rated frequency after taking into account, where this is appropriate, the effect of the specified d.c. component;
- when performing synthetic tests on circuit-breakers possessing arc-voltage characteristics which would significantly modify the current in service, the influence of the arc-voltage on the current amplitude and loop duration may be allowed for when considering the tolerances given above.

The detailed procedure for estimating these corrections with examples for establishing the tolerances is given in annex AA.

To keep within the tolerances for the test current, it is acceptable to increase the current by increasing the voltage or reducing the reactance of the current circuit, or to apply a current with an increased d.c. component or a reduced power frequency. For this purpose the specified tolerances for d.c. component and power frequency may be exceeded subject to the consent of the manufacturer.

4.1.2 Interaction interval

During the interaction interval, the short-circuit current stress changes into high-voltage stress and the circuit-breaker performance can significantly influence the current and voltages in the circuit. As the current decreases to zero, the arc voltage may rise to charge parallel capacitance and distort current passing through the arc. After the current-zero the post-arc conductivity may result in additional damping of the transient recovery voltage and thus influence the voltage across the circuit-breaker and the energy supplied to the ionised contact gap. The interaction between the circuit and the circuit-breaker immediately before and after current-zero (i.e. during the interaction interval) is of extreme importance to the interrupting process.

During the interaction interval the current and voltage wave forms shall be the same for a synthetic test as under reference system conditions (3.14), taking into account the possible deviations of the current and voltage from the prospective values due to the interaction between the circuit-breaker and the circuit.

The interaction interval presents the critical time for the thermal failure mode of the circuit-breaker. Therefore, it is of extreme importance that the shape and magnitude of the prospective transient recovery voltage (TRV) corresponds to that associated with the prospective current of the relevant test-duty.

Cela impose des exigences strictes pour le circuit d'essai. Pour la méthode par injection de courant, les exigences sont indiquées au 4.2.1 et pour la méthode par injection de tension, les exigences sont indiquées au 4.2.2.

NOTE Selon le circuit utilisé, l'interaction entre le circuit et le disjoncteur en essai peut être perturbée par la présence du disjoncteur auxiliaire pendant la période critique autour du zéro de courant.

Il convient que la tension d'arc du disjoncteur auxiliaire soit inférieure ou égale à la tension d'arc du disjoncteur en essai.

Si un disjoncteur auxiliaire à plus forte tension d'arc est utilisé, il peut être nécessaire d'augmenter la tension à fréquence industrielle du circuit fort courant.

4.1.3 Période de contrainte diélectrique

Pendant cette période, l'intervalle entre contacts du disjoncteur en essai est contraint par la tension de rétablissement.

La TTR présumée doit satisfaire aux prescriptions des 4.102, 4.105, 4.106 et 6.104.5 de la CEI 60056. Les méthodes permettant de déterminer la TTR présumée dans les circuits d'essais synthétiques peuvent être choisies parmi celles décrites dans l'annexe GG de la CEI 60056.

L'impédance de la source de tension doit être assez faible pour mettre en évidence les réamorçages, s'il y en a.

NOTE 1 Si le disjoncteur en essai est équipé de résistances parallèles de faible valeur, une procédure spéciale peut être nécessaire (voir annexe FF).

NOTE 2 Si la TTR est obtenue depuis plusieurs sources, la forme de l'onde résultante ne devra pas présenter de discontinuité appréciable.

En principe, la tension de rétablissement à fréquence industrielle pour les séquences de coupure de courts-circuits doit satisfaire aux prescriptions du 6.104.7 de la CEI 60056. Pendant les essais synthétiques, la tension de rétablissement est fournie par le circuit de tension soit directement soit mis en série avec le circuit de courant. Cela fait apparaître une tension continue, une tension alternative ou leur combinaison, qui, dans la plupart des cas, décroît du fait de l'énergie limitée de la source de tension. Il peut alors ne pas être possible de maintenir la tension de rétablissement pendant au moins 0,1 s comme demandé au 6.104.7 de la CEI 60056. Ces écarts peuvent être acceptés si les conditions suivantes sont remplies:

- La valeur instantanée de la tension de rétablissement pendant une période égale au 1/8 d'un cycle de la fréquence assignée du disjoncteur ne doit pas être inférieure à la valeur instantanée équivalente de la tension de rétablissement à fréquence industrielle indiquée au 6.104.7 de la CEI 60056 qui apparaît avec une valeur crête minimale de $0,95 h \sqrt{2} U / \sqrt{3}$.
 h = facteur de premier pôle (1,3 ou 1,5)
 U = tension assignée du disjoncteur.
- Si une tension de rétablissement continue, alternative, ou alternative et continue combinée décroissant exponentiellement est utilisée, sa valeur instantanée (pour la tension continue) ou sa valeur crête (dans les autres cas) devrait être, en principe, maintenue aussi près que possible de $\sqrt{2} U / \sqrt{3}$ et dans tous les cas, ne doit pas descendre au-dessous de $0,5 \sqrt{2} U / \sqrt{3}$ en moins de 0,1 s (voir figure 2).
- Si une tension de rétablissement comme ci-dessus impose une contrainte incorrecte au disjoncteur par rapport à celle spécifiée dans les conditions du réseau de référence, on recherchera un autre circuit d'essai satisfaisant mieux à 6.104.7 de la CEI 60056 et aux limites indiquées ci-dessus.

The above implies strict requirements for the test circuit. The requirements are given for the current injection method in 4.2.1 and for the voltage injection method in 4.2.2.

NOTE Depending on the test circuit used, the interaction between circuit and test circuit-breaker may be disturbed by the behaviour of the auxiliary circuit-breaker during the critical interval around current-zero.

The arc-voltage of the auxiliary circuit-breaker should be less than or equal to the arc-voltage of the test circuit-breaker.

If an auxiliary circuit-breaker with a higher arc-voltage is used, a higher power-frequency voltage of the current circuit may be necessary.

4.1.3 High-voltage interval

During the high-voltage interval the gap of the test circuit-breaker is stressed by the recovery voltage.

The prospective TRV shall comply with the requirements of 4.102, 4.105, 4.106 and 6.104.5 of IEC 60056. Suitable methods for determining the prospective TRV in synthetic test circuits can be selected from annex GG of IEC 60056.

The impedance of the voltage circuit shall be low enough to give clear evidence of breakdown, if any.

NOTE 1 If the test circuit-breaker is fitted with low ohmic parallel resistors, a special procedure may be necessary (see annex FF).

NOTE 2 If the TRV is obtained from more than one source the overall wave shape should not show any appreciable discontinuity.

In principle, the power-frequency recovery voltage for the basic short-circuit test-duties shall equate with the requirements of 6.104.7 of IEC 60056. In synthetic testing the recovery voltage is supplied from the voltage circuit, either directly or in series with the current circuit. This gives a d.c. voltage, or a combined a.c. and d.c. voltage, or an a.c. voltage, which in most cases decays due to the limited energy of the voltage source. It may thus not be possible to maintain the recovery voltage for at least 0,1 s as specified in 6.104.7 of IEC 60056. Deviations from the specified recovery voltage are acceptable if the following conditions are met:

- The instantaneous value of the recovery voltage during a period equal to $1/8$ of a cycle of the rated frequency of the circuit-breaker shall be not less than the equivalent instantaneous value of the power-frequency recovery voltage specified in 6.104.7 of IEC 60056 which starts with a minimum peak value of $0,95 h \sqrt{2} U / \sqrt{3}$.
 h = first pole-to-clear factor (1,3 or 1,5).
 U = rated voltage of the circuit-breaker.
- Whether an exponentially decaying d.c., an a.c. or a combined a.c. and d.c. recovery voltage is used, its instantaneous value (for d.c.) or its peak value (or a.c. or combined a.c. and d.c.) should in principle be kept as close as possible to $\sqrt{2} U / \sqrt{3}$ and in any case must not fall below $0,5 \sqrt{2} U / \sqrt{3}$ in less than 0,1 s (see figure 2).
- If an exponentially decaying d.c. or a combined a.c. and d.c. recovery voltage imposes an inappropriate stress on the circuit-breaker compared to that due to the specified a.c. recovery voltage in reference system conditions, then a more appropriate circuit may be used taking into account 6.104.7 of IEC 60056 and also the limits stated above.

4.2 Exigences spécifiques de chaque circuit d'essais synthétiques pour les essais de coupure

4.2.1 Méthodes par injection de courant

En termes généraux, ces méthodes peuvent se décrire ainsi (voir annexe BB):

- le courant de la source de tension est superposé au courant dans le disjoncteur en essai avant la période d'interaction;
- un disjoncteur auxiliaire coupe le courant de la source de courant avant la période d'interaction.

Pendant la période d'interaction, le disjoncteur en essai est soumis à la tension du circuit de tension dont l'impédance représente celle du réseau de référence. Cela explique la validité des méthodes par injection de courant. Plusieurs méthodes de ce type sont connues mais seule l'injection de courant parallèle est décrite ici puisque c'est celle utilisée par la plupart des laboratoires d'essais. Les conditions suivantes doivent être remplies:

a) *Circuit représentant la TTR*

- 1) La forme et l'amplitude de la TTR présumée doivent satisfaire aux exigences spécifiées.
- 2) L'impédance d'onde équivalente Z_h (voir figure 3) doit, idéalement être égale à $(du/dt)/(di/dt)$ pendant la période d'interaction. du/dt est la pente de la tension transitoire de rétablissement spécifiée et di/dt est la pente du courant de court-circuit spécifié.
- 3) La combinaison des capacités C_{dh} localisées ou réparties, en parallèle avec Z_h provoque le temps de retard $t_d = Z_h C_{dh}$.

b) *Inductance de la source de tension*

La valeur de l'inductance doit être comprise entre 1,0 et 1,5 fois l'inductance calculée à partir de la tension à fréquence industrielle équivalente divisée par le courant présumé.

c) *Fréquence du courant injecté et instant d'injection*

La fréquence du courant injecté sera de préférence de l'ordre de 500 Hz avec une limite inférieure de 250 Hz et une limite supérieure de 1 000 Hz.

L'instant initial du courant injecté sera ajusté de façon telle que le temps durant lequel le disjoncteur en essai est alimenté uniquement par le courant injecté soit moins d'un quart de période de la fréquence du courant injecté, avec un maximum de 500 μ s.

C'est pour éviter une déformation anormale du courant à fréquence industrielle que la limite inférieure est fixée à 250 Hz.

La fréquence maximale du courant injecté est déterminée par la période de changement significatif de la tension d'arc, période qui doit être plus courte que le temps pendant lequel l'arc est alimenté uniquement par le courant injecté. Pour cela, la période du courant injecté devra être au moins quatre fois la durée du changement significatif de tension d'arc (voir annexe BB).

NOTE Il est conseillé de veiller à ne pas contraindre indûment le disjoncteur lorsque le temps où le disjoncteur en essai est alimenté seulement par le courant injecté est inférieur à 200 μ s.

d) *Forme de l'onde de courant injecté*

La pente présumée de décroissance (di/dt) du courant injecté doit correspondre à celle du courant présumé à fréquence industrielle.

Pratiquement, aucune oscillation ne doit perturber le courant injecté pendant au moins 100 μ s avant le zéro de courant.

4.2 Synthetic test circuits and related specific requirements for breaking tests

4.2.1 Current injection methods

These methods can be described in terms of general principles as follows (see annex BB):

- the current from the voltage source is superimposed on the current in the test circuit-breaker prior to the interaction interval;
- an auxiliary circuit-breaker interrupts the current from the current circuit prior to the interaction interval.

During the interaction interval the test circuit-breaker is exposed to the voltage of the voltage circuit having an impedance which is representative of the reference system conditions. This explains the validity of current injection methods. Several current injection methods are known but only the conditions for parallel current injection are given below since this method is used by the majority of the test laboratories. The following conditions shall be met:

a) *TRV wave-shaping circuit*

- 1) The shape and magnitude of the prospective TRV shall comply with the specified values.
- 2) Ideally the equivalent surge impedance Z_h (see figure 3) shall be equal to $(du/dt)/(di/dt)$ during the interaction interval. (du/dt) is the rate of rise of the specified transient recovery voltage and di/dt is the rate of decrease of the specified short-circuit current.
- 3) The combination of the stray and lumped capacitance C_{dh} in parallel with Z_h gives rise to the delay time $t_d = Z_h C_{dh}$.

b) *Inductance of the voltage circuit*

The value of the inductance of the voltage circuit shall be between 1,0 and 1,5 times the inductance derived from the equivalent power-frequency voltage divided by the prospective current.

c) *Frequency of the injected current and the injection timing*

The frequency of the injected current shall preferably be of the order of 500 Hz with a lower limit of 250 Hz and an upper limit of 1 000 Hz.

The initiation of the injected current shall be adjusted such that the time, during which the test circuit-breaker is fed only by the injected current, is not more than a quarter of the period of the injected current frequency with a maximum of 500 μ s.

In order to prevent undue influence on the wave shape of the power-frequency current, the lower limit of the frequency of the injected current is 250 Hz.

The maximum frequency of the injected current is determined by the interval of significant change of arc-voltage, which interval shall be smaller than the time for which the arc is fed only by the injected current. To achieve this, the period of the injected frequency should be at least four times the interval of significant change of arc-voltage (see annex BB).

NOTE Attention should be paid to the possible overstressing of the circuit-breaker if the time that the test circuit-breaker is fed by the injected current only is less than 200 μ s.

d) *Waveshape of the injected current*

The prospective rate of decrease (di/dt) of the injected current shall correspond to that of the prospective power-frequency current.

The injected current shall be practically free of superimposed oscillations for a time not less than 100 μ s before current-zero.

4.2.2 Méthode par injection de tension

Plusieurs méthodes par injection de tension sont connues, mais seule la méthode d'injection série est décrite ici en termes généraux comme suit (voir aussi l'annexe CC):

- La tension fournie par la source de tension est appliquée au disjoncteur en essai après la période d'interaction.
- Un disjoncteur auxiliaire et un condensateur en parallèle avec lui permettant d'appliquer la tension de rétablissement au disjoncteur en essai.
- Pendant les périodes de fort courant et d'interaction, seule la source de courant alimente le disjoncteur en essai.

Si cette méthode est utilisée pour vérifier l'absence de réallumages thermiques, par exemple pendant les essais de défauts aux bornes avec application de la tension transitoire de rétablissement initiale (TTRI) ou pendant les essais de défauts proches en ligne, il est nécessaire de démontrer la validité du circuit d'essai pendant la période d'interaction. Cela est soumis à un accord entre constructeur, utilisateur et représentant de la station d'essais.

Si cette méthode est utilisée pour vérifier l'absence de réamorçages diélectriques, les conditions suivantes doivent être respectées:

- il convient que le disjoncteur auxiliaire ait une tension d'arc inférieure ou égale à celle du disjoncteur en essai. Cette condition est remplie si les pointes d'extinction des deux disjoncteurs sont sensiblement les mêmes (voir la note du 4.1.2);
- l'impédance du circuit de tension doit être assez faible pour permettre les réallumages ou les réamorçages s'ils apparaissent.

La capacité aux bornes du disjoncteur auxiliaire doit donc être d'au moins 10 nF. Il convient de prendre des dispositions pour éviter une distorsion anormale du courant avant le zéro de courant à fréquence industrielle;

- aucune interruption de la contrainte ne doit provenir de la combinaison du circuit de courant et du circuit de tension.

NOTE Pour les essais de défauts proches en ligne, en complément de la source d'injection de tension appliquant la TTR du côté réseau, une source d'injection de courant peut être reliée du côté ligne du disjoncteur en essai pour appliquer la composante de la TTR provenant de cette ligne courte.

4.2.3 Circuit de Skeats (ou par transformateur)

Cette méthode est principalement caractérisée comme suit (voir aussi l'annexe DD):

- les courant et tension proviennent d'une même source;
- la tension de rétablissement à fréquence alternative est fournie par un transformateur élévateur dont le primaire est raccordé à la source de courant;
- la tension de rétablissement est appliquée au disjoncteur en essai par l'intermédiaire d'une impédance (généralement une résistance).

Le disjoncteur auxiliaire coupe le courant avant le disjoncteur en essai (le plus souvent environ 10 μ s). Pendant ce court intervalle de temps, la valeur de la pente de courant di/dt dans le disjoncteur en essai est diminuée.

Ce circuit n'est donc pas valable pour réaliser des essais destinés à vérifier l'absence de réallumages thermiques du disjoncteur en essai.

Ce circuit convient pour essayer le comportement diélectrique du disjoncteur.

Ce circuit peut être utilisé pour les essais de fermeture.

4.2.2 Voltage injection method

Several voltage injection methods are known but only series voltage injection is described here in general terms as follows (see also annex CC):

- The voltage from the voltage circuit is applied to the test circuit-breaker after the interaction interval.
- An auxiliary circuit-breaker with a parallel capacitor is used to apply the recovery voltage to the test circuit-breaker.
- During the high-current and interaction intervals the test circuit-breaker is exposed to the current circuit only.

If the voltage injection method is to be used to check the thermal behaviour of the circuit-breaker, i.e. to test under terminal fault conditions with initial transient recovery voltage (ITRV) stress or under short-line-fault conditions, it is necessary to demonstrate the validity of the test circuit for the interaction interval. This is subject to agreement between manufacturer, testing station and user.

When used for tests relating to the dielectric behaviour of the circuit-breaker, the following conditions shall be met:

- the auxiliary circuit-breaker should have an arc-voltage less than or equal to that of the test circuit-breaker. This condition is met if the extinction peaks of both circuit-breakers are approximately the same (see note in 4.1.2);
- the impedance of the voltage circuit shall be low enough to provide for reignitions or restrikes if they occur.

Therefore, the capacitance across the auxiliary circuit-breaker shall be at least 10 nF. Care should be taken to avoid undue distortion of the current before power-frequency current-zero;

- no pause shall be introduced by the combining of the current circuit and the voltage circuit.

NOTE For short-line fault tests, in addition to the voltage injection circuit supplying the source side TRV, a current injection circuit which is connected to the line-side terminal of the test circuit-breaker can be used to supply the line-side transient voltage.

4.2.3 Duplicate circuit method (transformer or Skeats circuit)

This method can be described in terms of general principles as follows (see also annex DD):

- the current and voltage are supplied from the same source;
- the a.c. recovery voltage is supplied from a step-up transformer the primary of which is connected to the current circuit;
- the recovery voltage is applied to the test circuit-breaker through an impedance (normally a resistance).

The auxiliary circuit-breaker interrupts the current prior to the test circuit-breaker by a short time interval (usually about 10 μ s). During this short interval the value of di/dt of the current in the test circuit-breaker is decreased.

The test circuit is therefore not valid for tests where attention is paid to the thermal failure mode of the test circuit-breaker.

The test circuit is suitable for testing the dielectric behaviour of a circuit-breaker.

The test circuit can be used for making tests.

Il peut être facilement modifié pour fournir la pleine contrainte de tension pendant deux manoeuvres d'une séquence (ou plus), par exemple aux fermeture et ouverture d'un cycle CO, aux ouvertures d'un cycle O – t – CO et même à des zéros de courant consécutifs d'une manoeuvre d'ouverture. Voir l'annexe DD.

4.2.4 Autres méthodes d'essais synthétiques

D'autres méthodes peuvent être valables ou avantageuses pour l'essai de disjoncteurs de caractéristiques spécifiques ou pour l'essai de disjoncteurs à des performances spécifiques. Même lorsque ces méthodes ne sont pas décrites dans la présente norme, il peut être possible de les appliquer sous réserve d'une étude détaillée des conditions d'utilisation et de l'accord du constructeur et de l'utilisateur.

Les méthodes synthétiques pour des essais triphasés de coupure de court-circuit sont décrites dans la CEI 61633.

Une méthode d'essai, applicable aux disjoncteurs munis d'une résistance parallèle, est décrite dans l'annexe FF.

5 Essais d'établissement en court-circuit

5.1 Principes fondamentaux et exigences générales pour les essais synthétiques d'établissement en court-circuit

Pendant une fermeture sur un court-circuit, la distance entre contacts du disjoncteur est soumise à une tension correspondant à la valeur efficace de la tension assignée par $\sqrt{3}$, contrainte qui cause son franchissement. Après cet instant, le disjoncteur supporte le courant de fermeture qui s'exprime par sa valeur crête $\hat{i}$ dans la figure 4 (voir 4.103 de la CEI 60056).

Dans un circuit d'essais synthétiques, la tension appliquée est fournie par une source de tension séparée et le courant de court-circuit par une source de courant à tension réduite. Cette dernière est connectée au disjoncteur immédiatement après franchissement de l'espace entre contacts au moyen d'un enclencheur rapide, par exemple un éclateur commandé.

Toute méthode particulière d'essais synthétiques doit fournir les contraintes valides sur le disjoncteur en essai. Généralement, cette validité est établie quand les exigences ci-dessous sont respectées.

Périodes principales

Avant la fermeture, un disjoncteur supporte entre ses contacts la tension assignée entre phase et terre; à la fermeture, il est traversé par le courant de court-circuit assigné. Si les contraintes de tension et de courant sont plus finement étudiées pendant cet essai de fermeture – figure 4 – trois périodes principales apparaissent:

- La période de haute tension

La période de haute tension est le temps entre le commencement de l'essai, disjoncteur ouvert, et le moment de l'amorçage de l'espace entre contact.

- La période de pré-arc

La période de pré-arc est le temps, pendant le déplacement en fermeture des contacts du disjoncteur, entre l'instant d'amorçage de l'espace entre contacts et l'instant où les contacts se touchent.

- La période d'arrêt

La période d'arrêt est le temps, pendant la fermeture du disjoncteur, séparant l'instant où les contacts se touchent de l'instant où le mouvement des contacts s'arrête (position fermée).

The test circuit can easily be adapted to supply full voltage stresses in two (or more) operations e.g. at both closing and opening in a CO operation, at both openings in an O – t – CO operation or even at consecutive current-zeros in an opening operation. See annex DD.

4.2.4 Other synthetic test methods

Other methods may prove correct and advantageous for testing of circuit-breakers with specific characteristics or for testing of a circuit-breaker for specific performance. Even though these methods are not covered by this standard, they can be used subject to understanding of their application and agreement between the manufacturer and the user.

Synthetic methods for three-phase short-circuit breaking tests are reported in IEC 61633.

A method available for testing circuit-breakers having parallel resistors is reported in annex FF.

5 Short-circuit making tests

5.1 Basic principles and general requirements for synthetic making test methods

During a closing operation onto a short-circuit, the circuit-breaker contact gap is subjected to the applied voltage corresponding to the r.m.s. value of the rated voltage divided by $\sqrt{3}$ which causes its breakdown. After this moment, the circuit-breaker is subjected to the making current which is expressed by its maximum amplitude $\hat{i}$ in figure 4 (see 4.103 of IEC 60056).

In a synthetic test circuit the applied voltage is supplied by a separate voltage source and the short-circuit current is supplied by a reduced voltage current circuit. This latter is connected to the circuit-breaker immediately after breakdown of the contact gap by means of a fast making device, e.g. a triggered spark gap.

Any particular synthetic method chosen for testing shall adequately stress the test circuit-breaker. Generally the adequacy is established when the test method meets the requirements set forth in the following subclauses.

Basic intervals

Prior to making, a circuit-breaker withstands the rated phase-to-earth voltage applied across its terminals: during making, it carries the rated short-circuit current. If closer attention is paid to the voltage and current stresses during the making test – figure 4 – three main intervals can be recognised:

- High-voltage interval

The high-voltage interval is the time from the commencement of the test, with the circuit-breaker in the open position, to the moment of breakdown across the contact gap.

- Pre-arcing interval

The pre-arcing interval is the time, during the closing stroke of the circuit-breaker, from the moment of breakdown across the contact gap to the touching of the contacts.

- Latching interval

The latching interval is the time, during the closing stroke of the circuit-breaker, from the touching of the contacts to the moment when the contacts reach the fully closed (latched) position.

5.1.1 Période de haute tension

Pendant cette période, le disjoncteur se verra appliquer par le circuit d'essais des conditions initiales de la période de pré-arc identiques, sous réserve de certaines tolérances à spécifier, à celles imposées par le réseau de référence, dans les conditions correspondantes à l'essai.

Les conditions suivantes devront donc être respectées:

- La tension appliquée satisfera à la prescription du 6.104.1 de la CEI 60056.
- L'écart de phase entre la tension appliquée et le courant de court-circuit devra correspondre au facteur de puissance assignée du circuit d'essai avec les tolérances indiquées au 6.103.1 de la CEI 60056.

5.1.2 Période de pré-arc

Pendant cette période, des forces électrodynamiques sont produites par le courant sur le disjoncteur et l'énergie d'arc produit des dégradations. En général, le courant possède trois composantes:

- le courant transitoire initial de fermeture, ITMC,
- les composantes continue et alternative du courant de court-circuit.

Deux cas typiques peuvent se présenter selon l'instant de fermeture et le type du disjoncteur:

- L'amorçage apparaît près de la crête de la tension appliquée, établissant un courant presque symétrique: l'énergie du pré-arc et l'ITMC sont relativement élevés.
- L'amorçage apparaît près du zéro de la tension appliquée, établissant un courant asymétrique. L'énergie de pré-arc et l'ITMC sont négligeables sauf dans le cas de fermeture non simultanée dans un pôle multichambres.

NOTE L'ITMC n'est pas défini, explicitement au 4.103 de la CEI 60056, mais une valeur permettant de maintenir le pré-arc suffit pour l'essai.

5.1.3 Période d'arrêt et position de fermeture complète

Pendant ces périodes, le disjoncteur doit se fermer en présence des forces électrodynamiques dues au courant, et des forces de frottement des contacts. Le courant de fermeture doit donc satisfaire aux conditions du 4.103 de la CEI 60056 pendant ces périodes.

5.2 Circuit d'essais synthétiques pour essais de fermeture et exigences spécifiques s'y rapportant

5.2.1 Circuit d'essais

Comme on peut le voir à la figure 6, le circuit d'essai se compose de deux sources, à savoir le circuit de courant et le circuit de tension.

- Le circuit de tension, composé principalement d'un transformateur de faible puissance, fournit:
 - la tension appliquée pendant la période de contrainte diélectrique;
 - l'ITMC pendant la période de courant de pré-arc, par la décharge du circuit ITMC.
- Le circuit de courant à fréquence industrielle fournit le courant de fermeture pendant les périodes de courant de pré-arc et d'arrêt.

5.1.1 High-voltage interval

During this interval the circuit-breaker shall be stressed by the test circuit in such a way that the starting conditions for the pre-arcing interval, within the tolerances to be specified, are the same as under reference system conditions.

Therefore the following conditions shall be met:

- The applied voltage shall comply with the requirement set forth in 6.104.1 of IEC 60056.
- The phase relationship between the applied voltage and the short-circuit current shall correspond to the rated power factor of the test circuit within the tolerances given in 6.103.1 of IEC 60056.

5.1.2 Pre-arcing interval

During pre-arcing the circuit-breaker is subjected to electrodynamic forces due to the current and to deteriorating effects due to arc-energy. In general the current is composed of three components:

- the initial transient making current, ITMC,
- the d.c. and a.c. components of the short-circuit current.

Two typical cases may occur depending on the moment of closing and on the circuit-breaker design:

- Breakdown occurs near the crest of the applied voltage; an almost symmetrical current is established. Pre-arc energy and ITMC are relatively high.
- Breakdown occurs near zero of the applied voltage; an asymmetrical current is established. Pre-arc energy and ITMC are negligible with the exception of the case of non-simultaneous closing in a multi-unit pole.

NOTE The ITMC is not defined in 4.103 of IEC 60056; a value sufficient to maintain pre-arcing is adequate.

5.1.3 Latching interval and fully closed position

During these intervals the circuit-breaker has to close in presence of the electrodynamic forces due to the current and contact friction forces. Therefore during these intervals the making current shall comply with 4.103 of IEC 60056.

5.2 Synthetic test circuit and related specific requirements for making tests

5.2.1 Test circuit

The test circuit is made up with two sources namely the current and the voltage circuit as shown in figure 6.

- The voltage circuit, which mainly consists of a low power transformer, supplies:
 - the applied voltage during the high-voltage interval;
 - the ITMC during the pre-arcing interval, by the discharge of the ITMC-circuit.
- The current circuit supplies the making current during the pre-arcing, and latching intervals.

5.2.2 Conditions spécifiques

Lors d'un essai synthétique de fermeture, le déphasage entre la tension d'essai appliquée et le courant de court-circuit dépend des paramètres suivants:

- déphasage entre u_1 et u_2 ;
- temps de retard des enclencheurs;
- tension minimale d'amorçage de l'éclateur-enclencheur commandé.

Le déphasage entre la tension appliquée et le courant de court-circuit doit être de 90 ± 27 degrés électriques.

Le courant injecté fourni par le circuit de tension permet au courant de pré-arc de s'établir avant l'amorçage de l'éclateur. En conséquence, la constante de temps du circuit ITMC sera plus grande que le temps de retard de l'éclateur de fermeture.

NOTE La source de tension u_2 est soit une source alternative soit une source continue.

6 Exigences particulières pour les essais synthétiques d'établissement et de coupure relatives aux prescriptions des paragraphes 6.102 à 6.111 de la CEI 60056

Les paragraphes 6.102 à 6.111 de la CEI 60056 sont également applicables aux essais synthétiques. Cependant, des procédés spéciaux sont nécessaires dans les quelques cas qui sont mentionnés dans les paragraphes de cet article. Ces paragraphes se réfèrent à ceux de la CEI 60056 de mêmes numéros.

6.102.1.3 Essais en plusieurs parties

Des méthodes d'essais synthétiques des disjoncteurs équipés de résistances de faible valeur en parallèle sont données dans l'annexe FF.

6.102.2 Disposition du disjoncteur pour les essais

Pour les méthodes synthétiques relatives aux circuits triphasés, se reporter à la CEI 61633.

6.102.9 Disjoncteur comportant de courtes durées d'arc

De manière à réaliser les essais synthétiques avec les mêmes bases que les essais directs, il sera normalement nécessaire d'utiliser les méthodes spéciales de réallumages pour maintenir l'arc du disjoncteur en essai pendant le nombre nécessaire de zéros du courant à fréquence industrielle. L'annexe HH donne des exemples de circuits permettant la prolongation de l'arc.

NOTE Une méthode utilisant l'application multiple de la source de tension requiert en pratique une procédure identique à celle des essais directs. La source de tension est connectée au disjoncteur en essai à chaque zéro de courant. Si le disjoncteur en essai interrompt au moment d'un zéro, la procédure est arrêtée. Si le disjoncteur en essai réallume, la source de courant est alors connectée à nouveau en réallumant le disjoncteur auxiliaire. Au même moment, la source de tension est déconnectée, puis connectée à nouveau au zéro de courant suivant et sa polarité est inversée comme il convient. Toutefois, cette procédure est rarement utilisée à cause de sa complexité.

La méthode «pas à pas» est la méthode utilisée dans la plupart des essais synthétiques. La méthode est considérée comme étant une approximation suffisamment proche de la procédure d'essais directs.

5.2.2 Specific requirements

During a synthetic making test the phase relationship between the applied test voltage and the short-circuit current depends on the following parameters:

- phase displacement between the current source voltage u_1 and the voltage source voltage u_2 ;
- delay time of making gap;
- minimum sparkover voltage of making gap.

The phase displacement between the applied voltage and the short-circuit current shall be 90 ± 27 electrical degrees.

The injected current supplied by the voltage circuit ensures pre-arcing before the closing of the fast make gap. Therefore the time constant of ITMC-circuit shall be longer than the make gap delay time.

NOTE The voltage source u_2 may be an a.c. or a d.c. source.

6 Specific requirements for synthetic tests for making and breaking performance related to the requirements of subclauses 6.102 to 6.111 inclusive of IEC 60056

Subclauses 6.102 to 6.111 inclusive of IEC 60056 are also applicable for synthetic testing. However, in some cases special techniques are necessary. These cases are mentioned in the subclauses of this clause. The numbering of the subclauses corresponds to that of IEC 60056.

6.102.1.3 Multi-part testing

For synthetic methods for the testing of circuit-breakers fitted with low-ohmic parallel resistors see annex FF.

6.102.2 Arrangement of circuit-breaker for tests

For synthetic methods for three-phase testing refer to IEC 61633.

6.102.9 Circuit-breakers with short arcing times

In order to be able to perform synthetic tests on the same basis as direct tests, normally it will be necessary to apply special reignition methods to prolong the arcing of the test circuit-breaker through the necessary number of zeros of the power-frequency current. See annex HH for reignition methods to prolong arcing.

NOTE A method with multiple application of the voltage source involves practically the same procedure as for direct testing. The voltage source is connected to the test circuit-breaker at each current-zero. If the test circuit-breaker clears at a zero, the procedure is stopped. If the test circuit-breaker reignites, then the current source is reconnected by reigniting the auxiliary breaker. At the same time, the voltage source will be disconnected and then reconnected at the next current-zero, with its polarity reversed appropriately. However, such a procedure is rarely used, because of its complexity.

The "step-by-step" method is the method used on most synthetic tests. The method is considered to be a sufficiently close approximation of the direct testing procedure.

La durée d'arc est prolongée par réallumages thermiques. Etant donné que cette méthode permet d'imposer que le disjoncteur en essai réallume en toutes circonstances, on doit veiller à ne pas réallumer le disjoncteur à un zéro de courant où il peut couper. Pour cela, il est nécessaire de déterminer pour chaque essai de défaut aux bornes, de défaut proche en ligne et de discordance de phase, la durée d'arc minimale du disjoncteur. Au moins deux essais, une coupure et un réallumage, sont nécessaires à cette détermination. La différence de durée d'arc entre ces deux essais est limitée à environ 1 ms.

La coupure au temps d'arc minimal est la première coupure valable.

L'autre essai est aussi réalisé pour prouver que le réallumage à un zéro de courant prématuré, c'est-à-dire avec un temps d'arc juste inférieur au temps d'arc minimal, lors d'une coupure à un temps d'arc maximal, se produirait entre les contacts d'arc.

NOTE 1 Les essais supplémentaires nécessaires pour prouver le comportement correct aux zéros de courant prématurés ne contribueront généralement que dans une faible mesure à l'usure des contacts, etc., étant donné la courte durée d'arc. C'est pourquoi la remise en état de l'appareil n'est pas nécessaire du fait de ces essais.

NOTE 2 Le ou les réallumages obtenus durant la détermination de la durée d'arc minimale n'indiquent pas un défaut du disjoncteur. Cependant, il est important de vérifier que ce réallumage s'est produit entre les contacts d'arc uniquement. Cela permet de prouver la coordination de la tenue en tension lors des réallumages diélectriques, au moins pour la position des contacts correspondante. Lorsque l'on utilise une méthode par injection de courant, la coupure du courant injecté quelques alternances après le réallumage est souvent un moyen utile d'appréciation. L'examen détaillé des écrans, des contacts d'arc et des contacts principaux, etc., a aussi lieu d'être effectué pour vérifier le comportement correct.

Pour les essais de défaut en ligne, le réallumage est généralement dû à un échec thermique, aussi la coordination de la tenue en tension ne peut être concernée.

NOTE 3 Ce paragraphe traite des disjoncteurs à durée d'arc courte, mais les mêmes exigences sont en principe valables pour les disjoncteurs de durées d'arc plus longues.

6.106 Séquences d'essais de court-circuit fondamentales

Les séquences de manoeuvres pour les séries 1, 2, 3 et 5 et les variantes de la série 4 sont indiquées dans le tableau I.

Symboles: C_s = Manoeuvre de fermeture avec des paramètres spécifiques d'un circuit synthétique.

O_s = Manoeuvre d'ouverture du courant avec des paramètres spécifiques d'un circuit synthétique.

C_d = Manoeuvre de fermeture avec, pour tension appliquée réduite, la tension de la source de courant et, pour courant de fermeture, la valeur spécifiée.

O_d = Manoeuvre d'ouverture du courant avec, pour tension de rétablissement transitoire et à fréquence industrielle, la tension réduite de la source de courant et, pour courant, le courant spécifié de coupure.

NOTE 1 Du fait des possibilités des moyens d'essai synthétique, il peut être difficile de respecter les intervalles de temps spécifiés des séquences de manoeuvres assignées (voir le 6.105.1 de la CEI 60056).

NOTE 2 Pour satisfaire à toutes les conditions d'essai, il peut être nécessaire de réaliser plus de manoeuvres qu'indiqué dans la séquence de manoeuvres assignée. Le disjoncteur peut alors être remis en état après le nombre de manoeuvres de la séquence assignée.

6.106.1

6.106.2 Séquences nos 1, 2 et 3

6.106.3

Pour les séquences d'essais nos 1, 2 et 3, seules les manoeuvres d'ouverture sont spécifiées.

The arcing is prolonged by means of thermal reignitions. As this method makes it possible to force the test circuit-breaker to reignite in all conditions, special care shall be taken not to reignite the circuit-breaker at the instant of a current-zero when the circuit-breaker can clear. For this purpose it is necessary to determine, for each terminal fault, short-line fault and out-of-phase test duty, the minimum arcing time of the circuit-breaker. At least two breaking tests, one clearance and one reignition, are necessary for this determination. The arcing time difference between these two tests is limited to about 1 ms.

The clearance at the minimum arcing time is the first valid breaking operation.

The other test is also performed to demonstrate that a reignition at an early current zero, for example with an arcing time just below the minimum arcing time, as during a breaking operation at maximum arcing time, would take place between the arcing contacts.

NOTE 1 The extra tests necessary to demonstrate correct behaviour at early current zeros will usually contribute insignificantly to contact wear, etc., due to the short arcing times. Therefore, no reconditioning should be necessary because of these tests.

NOTE 2 The reignition(s) obtained when determining the minimum arcing time do(es) not indicate a fault of the circuit-breaker. However, it is important to establish that this reignition has taken place between the arcing contacts only. This may demonstrate the voltage withstand co-ordination at dielectric reignition, at least for the actual contact position. When using a current injection method the interruption of the injected current a few loops after the reignition is often a useful means for the judgement. Thorough inspection of screens, arcing and main contacts, etc., should also be made to verify correct behaviour.

For short-line-fault tests the reignition will usually be due to thermal failure, so that the voltage withstand co-ordination will not be involved.

NOTE 3 Although this subclause refers to circuit-breakers with short arcing times, the same requirements are in principle valid for circuit-breakers with longer arcing times.

6.106 Basic short-circuit test-duties

The operating sequences for test-duties Nos. 1, 2, 3 and 5 together with the various methods of carrying out test-duty No. 4 are shown in table I.

Symbols: C_s = Making operation with specified parameters in a synthetic circuit.
 O_s = Breaking operation with specified parameters in a synthetic circuit.
 C_d = Making operation with reduced applied voltage of the current source only and the specified making current.
 O_d = Breaking operation with reduced transient and power-frequency recovery voltages of the current source only and with the specified breaking current.

NOTE 1 Due to the characteristics of synthetic testing it may be difficult to comply with the specified time intervals of the rated operating sequence. See 6.105.1 of IEC 60056.

NOTE 2 In order to comply with all test requirements it may be necessary to make more operations than provided for in the rated operating sequence. In such cases the circuit-breaker may be reconditioned after the number of operations provided for in the rated operating sequence.

6.106.1

6.106.2 Test-duties Nos. 1, 2 and 3

6.106.3

For test-duties Nos. 1, 2, and 3, only breaking tests are specified.

6.106.4 Séquence no. 4

Plusieurs procédures peuvent être utilisées pour réaliser la séquence de manoeuvre assignée synthétiquement avec les paramètres spécifiés (voir le tableau 1).

Les méthodes suivantes sont disponibles:

Méthodes 1i) et 1ii)

Les méthodes 1i) ou 1ii) doivent être utilisées lorsque la constante de temps du circuit d'essais est égale à la valeur spécifiée associée au pouvoir de coupure assigné en court-circuit défini en 4.101.2 de la CEI 60056.

Les raisons du premier Os sont

- a) de respecter l'exigence d'avoir deux ou trois coupures (selon la séquence) aux valeurs spécifiées;
- b) de donner les renseignements nécessaires pour permettre le réglage des ordres de déclenchement pendant la séquence de la manoeuvre suivante. Cela permet de déterminer les conditions du temps d'arc minimales, comme si des essais directs avaient été réalisés aux valeurs spécifiées. Ces conditions peuvent être reproduites pendant la manoeuvre Od dans la séquence de manoeuvre suivante.

Les conditions à remplir lors de cet essai en deux parties sont les suivantes:

- a) la manoeuvre de coupure Od doit être réalisée avec le même temps d'arc minimal obtenu lors de la précédente coupure Os. Normalement, des méthodes de réallumage (voir annexe HH) sont nécessaires pour réaliser cela;
- b) la commande de l'ordre de déclenchement des manoeuvres d'ouverture doit satisfaire aux prescriptions de 6.102.9 (B) de la CEI 60056. Les temps d'arc lors de cette séquence, pour les réseaux à neutre isolé ou à la terre, doivent être conformes à ceux indiqués en 6.102.9 (B)1) de la CEI 60056.

Dans cette séquence,

- a) $C_{s_{sym}}$ a pour but de prouver l'enclenchement d'un courant symétrique égal au pouvoir de coupure en court-circuit selon 6.104.2 de la CEI 60056, avec une durée de pré-arc maximale. Cette manoeuvre de fermeture doit être réalisée avec une tension appliquée telle que celle spécifiée en 6.104.1 de la CEI 60056;
- b) $C_{d_{asy}}$ a pour but de prouver le pouvoir de fermeture assigné en court-circuit selon 6.104.2 de la CEI 60056. Pour prouver cela, la manoeuvre de fermeture peut être réalisée sous tension réduite en accord avec les limites indiquées en 6.104.2;
- c) aucune remise en état n'est autorisée pendant les séquences 1i) ou 1ii).

La méthode 1ii) peut être utilisée comme alternative à la méthode 1i) lorsque la station d'essais ne peut pas fournir un circuit d'essais tel que le disjoncteur puisse enclencher un courant symétrique égal au pouvoir de coupure assigné en court-circuit, sous une tension telle que spécifiée au en 6.104.1 de la CEI 60056, lors de la séquence de manoeuvre assignée. Dans ce cas, une manoeuvre de fermeture supplémentaire $C_{s_{sym}}$ doit être réalisée en enclenchant un courant symétrique égal au pouvoir de coupure assigné en court-circuit, comme indiqué en 6.104.2 de la CEI 60056, et une tension d'essais comme celle spécifiée en 6.104.1 de la CEI 60056.

Méthodes 2i) et 2ii)

Les méthodes 2i) ou 2ii) doivent être utilisées lorsque la constante de temps du circuit d'essais est inférieure à la valeur spécifiée associée au pouvoir de coupure assigné en court-circuit définie en 4.101.2 de la CEI 60056.

6.106.4 Test-duty No. 4

Several procedures may be used to perform the rated operating sequence synthetically with the specified parameters (see table 1).

The following methods are available:

Methods 1i) and 1ii)

Method 1i) or 1ii) shall be used when the time constant of the test circuit is equal to the standard value used for the rated short-circuit breaking current as defined by 4.101.2 of IEC 60056.

The purpose of the first Os is

- a) to comply with the requirement to have two or three (depending on the sequence) breaking operations at the specified values;
- b) to provide the necessary information to enable the control of the tripping impulse to be set for the relevant requirements during the subsequent operating sequence. This enables the minimum arcing time conditions to be established, as if direct tests were performed at specified values. These can then be reproduced during the Od operation in the subsequent operating sequence.

The conditions to be fulfilled during this two-part test are the following:

- a) the breaking operation Od shall be performed under the same minimum arcing time conditions deriving from the previously conducted Os. Normally, reignition methods (see annex HH) are necessary to achieve this;
- b) the control of the tripping impulse for the breaking operations of the operating sequence shall be in accordance with the requirements of 6.102.9 (B) of IEC 60056. The arcing time sequence, for both isolated and earthed neutral systems, shall reproduce that given in 6.102.9 (B)1) of IEC 60056.

In this sequence

- a) $C_{S_{sym}}$ is aimed at demonstrating the closing against a symmetrical current equal to the rated short-circuit breaking current according to 6.104.2 of IEC 60056, and the longest prestriking arc; this closing operation shall be carried out at an applied voltage as specified in 6.104.1 of IEC 60056;
- b) $C_{d_{asy}}$ is aimed at demonstrating the rated short-circuit making current according to 6.104.2 of IEC 60056. For this demonstration, the closing operation can be performed at reduced voltage with the limits stated in 6.104.2;
- c) no maintenance is allowed during sequence 1i) or 1ii).

Method 1ii) can be used as an alternative to method 1i) where the testing station is not able to provide a test circuit such that the circuit-breaker is closed against a symmetrical current equal to the rated short-circuit breaking current at an applied voltage as specified in 6.104.1 of IEC 60056 during the rated operating sequence. In this case, performance of a separate closing operation $C_{S_{sym}}$ against a symmetrical current equal to the rated short-circuit breaking current according to 6.104.2 of IEC 60056 at an applied voltage, as specified in 6.104.1 of IEC 60056, is required.

Methods 2i) and 2ii)

Method 2i) or 2ii) shall be used when the time constant of the test circuit is less than the standard value used for the rated short-circuit breaking current according to 4.101.2 of IEC 60056.

Les méthodes 2i) et 2ii) sont soumises aux mêmes règles et exigences que celles établies pour les méthodes 1i) et 1ii). A cause de la constante de temps du circuit d'essais, inférieure à la valeur spécifiée associée au pouvoir de coupure assigné en court-circuit définie en 4.101.2 de la CEI 60056, une manoeuvre de fermeture supplémentaire Cd_{asy} doit être réalisée, avec un courant crête égal au pouvoir de fermeture assigné en court-circuit. Cette séquence d'essais supplémentaire nécessite une valeur de courant efficace plus élevée.

NOTE La crête du courant pendant la deuxième fermeture, lors de la séquence de manoeuvre assignée complète, sera inférieure au pouvoir de fermeture assigné en court-circuit à cause de la valeur réduite de la constante de temps.

La méthode 2ii) peut être utilisée comme alternative à la méthode 2i) lorsque la station d'essais ne peut pas fournir un circuit d'essais tel que le disjoncteur puisse enclencher un courant symétrique égal au pouvoir de coupure assigné en court-circuit, sous une tension telle que celle spécifiée en 6.104.1 de la CEI 60056, lors de la séquence de manoeuvre assignée. Dans ce cas, une manoeuvre de fermeture supplémentaire Cs_{sym} doit être réalisée en enclenchant un courant symétrique égal au pouvoir de coupure assigné en court-circuit, comme indiqué en 6.104.2 de la CEI 60056, et une tension d'essais comme celle spécifiée en 6.104.1 de la CEI 60056.

Méthodes 3i) et 3ii)

Les méthodes 3i) ou 3ii) doivent être utilisées lorsque la constante de temps du circuit d'essais est supérieure à la valeur spécifiée associée au pouvoir de coupure assigné en court-circuit définie en 4.101.2 de la CEI 60056.

Les méthodes 3i) et 3ii) sont soumises aux mêmes règles et exigences que celles établies pour les méthodes 1i) et 1ii). A cause de la constante de temps du circuit d'essais, supérieure à la valeur spécifiée associée au pouvoir de coupure assigné en court-circuit défini en 4.101.2 de la CEI 60056, la crête de courant lors de la fermeture asymétrique Cd_{asy} sera supérieure au pouvoir de fermeture assigné en court-circuit. Par conséquent, il convient que la manoeuvre de fermeture soit contrôlée par un système de synchronisation sur l'onde de tension pour obtenir le pouvoir de fermeture assigné en court-circuit. La réalisation de la séquence de manoeuvre assignée avec un courant symétrique égal au pouvoir de coupure assigné en court-circuit et avec la fermeture sur un courant complètement asymétrique (ou en contrôlant l'instant de fermeture par un dispositif de synchronisation) est soumise à l'accord du constructeur. Dans ce cas, la séquence de manoeuvre assignée peut n'être réalisée qu'une seule fois. Sinon, la séquence de manoeuvre assignée peut être réalisée avec la première manoeuvre de fermeture sur un courant symétrique égal au pouvoir de coupure assigné en court-circuit et la seconde fermeture à vide; dans ce cas, la capacité du disjoncteur à réaliser la séquence de manoeuvre assignée sera démontrée en répétant la séquence de manoeuvre assignée, avec des exigences associées et un courant symétrique inférieur au pouvoir de coupure assigné en court-circuit, de telle sorte que le pouvoir de fermeture assigné en court-circuit soit obtenu lors de la fermeture asymétrique. Lors de cette répétition de la séquence d'essais, les manoeuvres de fermeture peuvent être réalisées sous tension réduite.

NOTE Comme la capacité du disjoncteur à fermer sur le pouvoir de fermeture assigné en court-circuit est démontrée lors de la répétition de la séquence de manoeuvre, une manoeuvre de fermeture supplémentaire sur le pouvoir de fermeture assigné en court-circuit indiqué en 6.104.2 n'est pas demandée.

La méthode 3ii) peut être utilisée comme alternative à la méthode 3i) lorsque la station d'essais n'est pas capable de fournir un circuit d'essais tel que le disjoncteur puisse enclencher un courant symétrique égal au pouvoir de coupure en court-circuit, sous une tension telle que celle spécifiée en 6.104.1 de la CEI 60056, lors de la séquence de manoeuvre assignée. Dans ce cas, une manoeuvre de fermeture supplémentaire Cs_{sym} doit être réalisée, en enclenchant un courant symétrique égal au pouvoir de coupure assigné en court-circuit, comme indiqué en 6.104.2 de la CEI 60056, et une tension d'essais comme celle spécifiée en 6.104.1 de la CEI 60056.

Lors de cette séquence d'essais, quand la répétition de la séquence de manoeuvre assignée est choisie, une remise en état est autorisée avant la répétition de la séquence.

Methods 2i) and 2ii) are subject to the same rules and requirements established for method 1i) and 1ii). Due to the smaller time constant of the test circuit with respect to the standard values used for the rated short-circuit breaking current as defined by 4.101.2 of IEC 60056, an additional separate closing operation Cd_{asy} , with current peak equal to the rated short-circuit making current shall be performed as a separate duty. This will require a higher r.m.s. value of current.

NOTE The current peak during the second closing in the complete rated operating sequence will be smaller than the rated short-circuit making current due to the smaller value of the time constant.

Method 2ii) can be used as an alternative to method 2i) where the testing station is not able to provide a test circuit such that the circuit-breaker closes against a symmetrical current equal to the rated short-circuit breaking current at an applied voltage as specified in 6.104.1 of IEC 60056 during the rated operating sequence. In this case, performance of an additional, separate closing operation Cs_{sym} is required against a symmetrical current equal to the rated short-circuit breaking current according to 6.104.2 of IEC 60056 at an applied voltage as specified in 6.104.1 of IEC 60056.

Methods 3i) and 3ii)

Method 3i) or 3ii) shall be used when the time constant of the test circuit is greater than the standard value used for the rated short-circuit breaking current according to 4.101.2 of IEC 60056.

Methods 3i) and 3ii) are subject to the same rules and requirements established for method 1i) and 1ii). Due to the larger time constant of the test circuit with respect to the standard value used for the rated short-circuit breaking current according to 4.101.2 of IEC 60056, the current peak during the asymmetrical closing Cd_{asy} will be larger than the rated short-circuit making current. Therefore, the closing operation may be controlled by use of point-on-wave control to obtain the rated short-circuit making current. Performance of the rated operating sequence with symmetrical current equal to the rated short-circuit breaking current and closing against a fully asymmetrical current (or using point-on-wave control) is subject to the consent of the manufacturer. In such a case, the rated operating sequence need be performed only once. Alternatively, the rated operating sequence can be performed with the first closing operation against a symmetrical current equal to the rated short-circuit breaking current and the second closing operation at no load; in this case, evidence of the ability of the circuit-breaker to perform the rated operating sequence will be demonstrated by repeating the rated operating sequence, with relevant requirements, and a symmetrical current smaller than the rated short-circuit breaking current in such a manner that the rated short-circuit making current is obtained in the asymmetrical closing. During this repeated duty, the closing operations may be performed at reduced voltage.

NOTE Since the ability of the circuit-breaker to close against the rated short-circuit making current is proven during the repeated duty, a separate closing operation against the rated short-circuit making current according to 6.104.2 is not required.

Method 3ii) can be used as an alternative to method 3i) where the testing station is not able to provide a test circuit such that the circuit-breaker closes against a symmetrical current equal to the rated short-circuit breaking current at an applied voltage as specified in 6.104.1 of IEC 60056 during the rated operating sequence. In this case, performance of an additional, separate, closing operation Cs_{sym} is required against a symmetrical current equal to the rated short-circuit breaking current according to 6.104.2 of IEC 60056 at an applied voltage as specified in 6.104.1 of IEC 60056.

During this test sequence, when repetition of the rated operating sequence is adopted, maintenance is permitted before the repetition of the duty.

6.106.5 Séquence n° 5

Pour les disjoncteurs à durée d'arc courte, trois manoeuvres d'ouverture doivent être faites quelle que soit la séquence de manoeuvres assignée.

NOTE Pour que le disjoncteur en essai soit soumis aux contraintes effectives et pour établir la durée d'arc minimale on peut faire un essai supplémentaire. Pour cet essai, l'ordre de déclenchement est placé comme pour la première manoeuvre valide, soit pendant ou même avant la petite alternance et l'injection de TTR après la petite alternance. Le disjoncteur devra réallumer dans cet essai. Il est important d'établir que le réallumage a eu lieu seulement entre les contacts (d'arc). Cela démontre la coordination des tenues en tension pendant les réamorçages diélectriques.

Pendant les essais avec courant asymétrique, la pente di/dt et la TTR sont modifiées par la présence de la composante continue. Pour les essais synthétiques, ces modifications doivent être préparées par:

a) Le contrôle de la composante continue du courant

La composante continue peut être contrôlée en choisissant le point de l'onde auquel le court-circuit est provoqué.

b) La réduction de di/dt au zéro de courant

La réduction de di/dt peut être obtenue pour les méthodes d'injection de courant, en réduisant la tension de charge du circuit de tension.

La formule à appliquer pour la détermination de la tension de charge réduite est:

$$U_{HA} = U_{HS} \left[\sqrt{1 - p^2} \pm \frac{p}{2 \pi f \cdot \tau} \right] \quad \begin{array}{l} + \text{ grande alternance} \\ - \text{ petite alternance} \end{array}$$

où

U_{HA} = tension de charge réduite pour l'essai asymétrique

U_{HS} = tension de charge pour l'essai symétrique équivalent

p = composante continue à l'instant du zéro de courant, par unité

τ = constante de temps selon la CEI 60056 (45 ms).

p peut être calculée à partir de l'asymétrie au moment de la séparation des contacts p_{sc} avec:

$$p = p_{sc} \cdot e^{-\frac{t_a}{\tau}}$$

où

t_a = durée d'arc

c) Correction de la TTR

1) Méthode simplifiée

Pour les TTR dont le temps t_2 n'excède pas 500 μs , une méthode simplifiée peut être utilisée. Celle-ci suppose que la correction de TTR (u_1 , t_1 , u_c , t_2) est proportionnelle à la correction des di/dt .

Alors la correction de TTR est automatiquement obtenue par l'application de b).

2) La méthode simplifiée ci-dessus n'est pas applicable à une TTR où t_2 est supérieure à 500 μs . Dans ce cas, un autre circuit doit être utilisé. La TTR présumée demandée est indiquée dans le tableau II.

6.106.5 Test-duty No. 5

On circuit-breakers having short arcing times three breaking operations shall be made irrespective of the rated operating sequence.

NOTE In order to ensure that the test circuit-breaker is correctly stressed and to establish the minimum arcing time, an extra test may be made. For this test the setting of the control of the tripping impulse has to be as prescribed for the first valid operation, i.e. in or even before the minor loop. The injection of the TRV has to be applied after the minor loop. In this test the test circuit-breaker should reignite. It is important to establish that this reignition has taken place between the arcing contacts only. This demonstrates the voltage withstand co-ordination at dielectric reignitions.

During tests with asymmetrical current both di/dt and the TRV are modified due to the d.c. component. In synthetic tests these modifications have to be pre-arranged by:

a) Control of the d.c. component of the current

The d.c. component may be controlled by selection of the point on the wave at which the short-circuit is initiated.

b) Reduction of di/dt at current-zero

The reduction of di/dt may for current injection methods be obtained by reducing the charging voltage of the voltage circuit.

The formula to be applied for the determination of the reduced charging voltage is:

$$U_{HA} = U_{HS} \left[\sqrt{1 - p^2} \pm \frac{p}{2\pi f \cdot \tau} \right] \quad \begin{array}{l} + \text{ for major loop} \\ - \text{ for minor loop} \end{array}$$

where:

U_{HA} = reduced charging voltage at asymmetrical test

U_{HS} = charging voltage for equivalent symmetrical test

p = the per unit value of the d.c. component at current zero

τ = time constant according to IEC 60056 (45 ms).

p can be calculated from the asymmetry at contact separation p_{CS} :

$$p = p_{SC} \cdot e^{-\frac{t_a}{\tau}}$$

where:

t_a = arcing time

c) Correction of TRV

1) Simplified method

For TRV's with time t_2 not exceeding 500 μs , a simplified method can be used. This method is based upon the supposition that the correction of TRV (u_1 , t_1 , u_c , t_2) is proportional to the correction for di/dt .

This means that the correction of TRV is automatically covered by the reduced di/dt according to b).

2) For TRV's with time t_2 exceeding 500 μs other corrections and/or circuit modifications have to be used. The required prospective TRV values are given in table II.

d) Correction de la tension de rétablissement

Quand l'essai représente la coupure à la fin d'une grande alternance, la forme apériodique de la tension de rétablissement réduite «couvrira» correctement le premier quart de période de la tension de rétablissement (de l'essai direct correspondant).

Ce n'est plus le cas pour la coupure à la fin d'une petite alternance, puisque la tension de rétablissement à fréquence industrielle continue normalement de croître après l'établissement de la TTR.

Sous réserve d'un accord entre la station d'essais, le constructeur et l'utilisateur, on peut juger que, avec les séquences d'essais asymétriques, on a assez d'éléments pour prouver les caractéristiques du disjoncteur. On estime qu'un essai asymétrique avec interruption après une petite alternance avec di/dt réduit et la TTR en résultant est moins sévère qu'un essai symétrique correspondant. Cependant, si l'on doit établir entièrement la validité de cette condition d'essai, on dispose de trois possibilités:

- 1) l'essai est réalisé avec des conditions de courant asymétrique avec une source de tension à pleine charge comme pour les essais symétriques. Il faut reconnaître que cela implique une augmentation considérable de la sévérité par rapport à un essai direct équivalent puisque di/dt et la TTR sont plus élevés;
- 2) l'essai est réalisé comme dans 1) mais l'inductance du circuit d'injection est augmentée en proportion inverse de di/dt . Dans ce cas, la valeur de di/dt est correcte, mais la TTR est plus élevée;
- 3) l'essai est réalisé avec une tension de rétablissement alternative.

6.109 Essais de défaut proche en ligne

Pour les essais synthétiques de défaut proche en ligne, les paramètres du circuit représentant la ligne courte sont ceux indiqués dans la CEI 60056. Ce circuit doit être inséré dans le circuit de courant pendant la totalité de la période d'interaction.

Avec des circuits d'injection de courant, le circuit de ligne courte peut se mettre en série avec le circuit de tension, son inductance devenant une partie de L_h , par exemple comme indiqué à la figure BB.1.

Ce circuit de défaut proche en ligne introduit dans le circuit de tension peut engendrer des oscillations qui se superposent à l'onde de courant injecté. Il convient que ces oscillations soient amorties (pour satisfaire aux exigences du 4.2.1d), de manière à ne pas perturber le courant pendant la période de changement significatif de la tension d'arc ou au moins pendant 100 μ s avant le zéro du courant.

Une résistance mise en série dans le circuit de TTR peut convenir. Dans la plupart des cas, la résistance destinée à imposer la pente initiale de la tension de rétablissement est suffisante pour assurer l'amortissement nécessaire.

NOTE Il est recommandé d'apporter un soin particulier à la répartition des tensions et au mesurage des TTR présumées lorsque le circuit représentant la ligne courte et le circuit de tension sont du même côté du disjoncteur en essai.

6.111 Méthodes d'essais synthétiques pour l'établissement et la coupure des courants capacitifs

Voir l'annexe GG.

d) Correction of recovery voltage

When a test is made for clearance at the end of a major loop the d.c. form of the reduced recovery voltage will adequately cover the first quarter loop of the recovery voltage (of an equivalent direct test).

For clearance at the end of a minor loop of current the d.c. form of the reduced recovery voltage will not cover reference system conditions since in the system the power-frequency recovery voltage continues to rise after the onset of the TRV.

Subject to agreement between testing station, manufacturer and user it may be considered that taken together with the symmetrical test-duties the evidence is sufficient to prove the performance of the circuit-breaker. An asymmetrical test with clearance after a minor loop with reduced di/dt and the resulting reduced TRV is assumed to be less severe than an equivalent symmetrical test. However, if it is required to prove fully this test condition, there are three possibilities:

- 1) the test is performed with asymmetrical current conditions with the voltage source charged as for the symmetrical test. It must be recognized that this represents a considerable increase in severity above that of an equivalent direct test since both di/dt and the TRV are higher;
- 2) the test is performed as under 1) except that the inductance of the injection circuit is increased in inverse proportion to di/dt . In this case, the di/dt value is correct but the TRV higher;
- 3) the test is performed with an a.c. recovery voltage.

6.109 Short-line fault tests

For short-line fault synthetic testing the parameters of the short-line circuit shall be those given in IEC 60056 and the line circuit shall be in the current carrying circuit during the whole interaction interval.

With current injection circuits the short-line circuit may be connected in series with the voltage circuit, its inductance becoming part of L_h , e.g. as shown in figure BB.1.

The presence of the short-line fault circuit in the voltage circuit may cause oscillations to be superimposed on the injected current wave. These oscillations should be damped out (to satisfy the requirements of 4.2.1d), so as not to affect the current during the interval of significant change of arc-voltage or at least 100 μ s before current-zero.

A resistance may be connected in series with the TRV shaping circuit. In most cases this resistance, selected to control the initial rate of rise of recovery voltage, is sufficient to supply the necessary damping.

NOTE If, for short line fault tests, the line is connected to the same side of the test circuit-breaker as the voltage circuit impedance, special attention should be given to voltage distribution and measurement of prospective TRV.

6.111 Synthetic methods for capacitive-current switching

See annex GG.

Tableau I – Séquence d'essais synthétiques pour les séquences 1, 2, 3, 4 et 5

Séquence d'essais no.	Essai synthétique		Séquence de manoeuvre assignée	
			$O - t - CO - t' - CO$ $t = 0,3 \text{ s ou } 3 \text{ min}$ $t' = 3 \text{ min}$	$CO - t'' - CO$ $t'' = 15 \text{ s}$
1, 2, 3	Manoeuvres de coupure ^e	i)	$Os - t - Os - t' - Os$	$Os - t'' - Os$
		ii)	Os $Od - t - Os - t' - Os$	Os $Od - t'' - Os$
4 ^d	Séquence de manoeuvres assignée complète		$Os - t - CsOs - t' - CsOs$	$CsOs - t'' - CsOs$
	Méthode 1 (constante de temps de la composante apériodique du circuit d'essais égale à la valeur spécifiée)	i)	Os $Od - t - Cs_{sym}Os - t' - Cd_{asy}Os$	Os $Cs_{sym}Od - t'' - Cd_{asy}Os$
		ii)	Cs_{sym} Os $Od - t - Cd_{sym}Os - t' - Cd_{asy}Os$	Cs_{sym} Os $Cd_{sym}Od - t'' - Cd_{asy}Os$
	Méthode 2 (constante de temps de la composante apériodique du circuit d'essais inférieure à la valeur spécifiée)	i)	Cd_{asy}^a Os $Od - t - Cs_{sym}Os - t' - Cd_{asy}Os$	Cd_{asy}^a Os $Cs_{sym}Od - t'' - Cd_{asy}Os$
		ii)	Cd_{asy}^a Cs_{sym} Os $Od - t - Cd_{sym}Os - t' - Cd_{asy}Os$	Cd_{asy}^a Cs_{sym} Os $Cd_{sym}Od - t'' - Cd_{asy}Os$
	Méthode 3 (constante de temps de la composante apériodique du circuit d'essais supérieure à la valeur spécifiée)	i)	Os $Od - t - Cs_{sym}Os - t' - (Cd_{asy}^b)Os$ $Od - t - Cd_{sym}Os - t' - Cd_{asy}Os^c$	Os $Cs_{sym}Od - t'' - (Cd_{asy}^b)Os$ $Cd_{sym}Od - t'' - Cd_{asy}Os^c$
		ii)	Cs_{sym} Os $Od - t - Cd_{sym}Os - t' - (Cd_{asy}^b)Os$ $Od - t - Cd_{sym}Os - t' - Cd_{asy}Os^c$	Cs_{sym} Os $Cd_{sym}Od - t'' - (Cd_{asy}^b)Os$ $Cd_{sym}Od - t'' - Cd_{asy}Os^c$
5	Manoeuvres de coupure ^e		Os Os Os	

^a La valeur efficace du courant pour cette manoeuvre est supérieure au pouvoir de coupure assigné en court-circuit pour obtenir la valeur crête requise du courant égale au pouvoir de fermeture assigné en court-circuit.

^b La valeur crête du courant pour cette manoeuvre peut être supérieure au pouvoir de fermeture assigné en court-circuit, selon qu'un système de contrôle de l'instant de fermeture par synchronisation est utilisé ou pas (voir les méthodes 3i) et 3ii)).

^c La valeur efficace du courant pour cette séquence est inférieure au pouvoir de coupure assigné en court-circuit pour obtenir la valeur crête requise du courant égale au pouvoir de fermeture assigné en court-circuit.

^d Pour la commodité des essais, il est permis d'échanger l'ordre de C_{sym} et C_{asy} lors de la séquence de manoeuvre assignée no. 4.

^e Pour la commodité des essais, il est permis d'introduire une manoeuvre de fermeture avant toute manoeuvre d'ouverture lors des séquences d'essais 1, 2, 3 et 5.

Table I – Synthetic test sequence for test-duties 1, 2, 3, 4 and 5

Test-duty No.	Synthetic test		Rated operating sequence	
			$O - t - CO - t' - CO$ $t = 0,3 \text{ s or } 3 \text{ min}$ $t' = 3 \text{ min}$	$CO - t'' - CO$ $t'' = 15 \text{ s}$
1, 2, 3	Breaking operations ^e	i)	$Os - t - Os - t' - Os$	$Os - t'' - Os$
		ii)	Os $Od - t - Os - t' - Os$	Os $Od - t'' - Os$
4 ^d	Complete rated operating sequence		$Os - t - CsOs - t' - CsOs$	$CsOs - t'' - CsOs$
	Method 1 (time constant of the d.c. component of the test circuit equal to the standard value)	i)	Os $Od - t - Cs_{sym}Os - t' - Cd_{asy}Os$	Os $Cs_{sym}Od - t'' - Cd_{asy}Os$
		ii)	Cs_{sym} Os $Od - t - Cd_{sym}Os - t' - Cd_{asy}Os$	Cs_{sym} Os $Cd_{sym}Od - t'' - Cd_{asy}Os$
	Method 2 (time constant of the d.c. component of the test circuit less than the standard value)	i)	Cd_{asy}^a Os $Od - t - Cs_{sym}Os - t' - Cd_{asy}Os$	Cd_{asy}^a Os $Cs_{sym}Od - t'' - Cd_{asy}Os$
		ii)	Cd_{asy}^a Cs_{sym} Os $Od - t - Cd_{sym}Os - t' - Cd_{asy}Os$	Cd_{asy}^a Cs_{sym} Os $Cd_{sym}Od - t'' - Cd_{asy}Os$
	Method 3 (time constant of the d.c. component of the test circuit greater than the standard value)	i)	Os $Od - t - Cs_{sym}Os - t' - (Cd_{asy}^b)Os$ $Od - t - Cd_{sym}Os - t' - Cd_{asy}Os^c$	Os $Cs_{sym}Od - t'' - (Cd_{asy}^b)Os$ $Cd_{sym}Od - t'' - Cd_{asy}Os^c$
		ii)	Cs_{sym} Os $Od - t - Cd_{sym}Os - t' - (Cd_{asy}^b)Os$ $Od - t - Cd_{sym}Os - t' - Cd_{asy}Os^c$	Cs_{sym} Os $Cd_{sym}Od - t'' - (Cd_{asy}^b)Os$ $Cd_{sym}Od - t''Cd_{asy}Os^c$
5	Breaking operations ^e		Os Os Os	

^a The r.m.s value of the current for this operation is higher than the rated short-circuit breaking current to obtain the required short-circuit making current peak.

^b The peak value of the current for this operation may be higher than the rated short-circuit making current depending on whether the closing operation is controlled by use of point on wave control or not (see methods 3i) and 3ii)).

^c The r.m.s value of the current for this sequence is less than the rated short-circuit breaking current to obtain the required short-circuit making current peak.

^d For convenience of testing, it is permissible to exchange the order of C_{sym} and C_{asy} during the rated operating sequence in test-duty No. 4.

^e For convenience of testing, it is permissible to introduce a closing operation before any opening operations in test-duties 1, 2, 3 and 5.

Tableau II/Table II

TTR après la coupure de courant asymétrique/TRV after breaking asymmetrical current

Fréquence / Frequency (Hz)		50												60																							
Tension / Voltage (kV)		245			300			362			420			525			765			245			300			362			420			525			765		
Instant/Time co-ordinate (µs)		t_1	t_2	u_c	t_1	t_2	u_c	t_1	t_2	u_c	t_1	t_2	u_c	t_1	t_2	u_c	t_1	t_2	u_c	t_1	t_2	u_c	t_1	t_2	u_c	t_1	t_2	u_c	t_1	t_2	u_c						
		u_i			u_i			u_i			u_i			u_i			u_i			u_i			u_i			u_i			u_i								
		Tension / Voltage (kV)																																			
Après une grande alternance : asymétrie à l'instant du zéro de courant After major-loop : asymmetry at current zero	0	260	364	318	446	384	538	446	624	557	780	812	1137	260	364	318	446	384	538	446	624	557	780	812	1137	260	364	318	446	384	538	446	624	557	780	812	1137
	5	260	363	319	445	385	536	446	621	557	775	811	1124	260	363	319	444	384	535	445	620	557	773	810	1121	260	363	319	444	384	535	445	620	557	773	810	1121
	10	260	362	318	442	384	532	445	616	556	768	808	1099	260	361	318	441	383	530	444	614	555	764	806	1102	260	361	318	441	383	530	444	614	555	764	806	1102
	15	259	359	317	439	382	527	443	610	553	758	804	1091	258	358	316	436	381	525	442	606	551	753	801	1080	258	358	316	436	381	525	442	606	551	753	801	1080
	20	257	356	315	434	380	521	440	602	549	747	797	1070	257	354	314	431	378	517	438	597	547	740	793	1055	257	354	314	431	378	517	438	597	547	740	793	1055
	25	255	351	312	428	376	514	436	593	543	734	788	1046	254	349	311	424	374	509	434	586	540	724	783	1027	254	349	311	424	374	509	434	586	540	724	783	1027
	30	252	346	308	421	371	504	430	581	536	718	776	1019	251	343	307	417	369	498	428	574	533	707	770	996	251	343	307	417	369	498	428	574	533	707	770	996
	35	248	339	303	412	365	494	423	568	527	701	763	988	247	336	302	407	363	487	420	560	523	688	756	962	247	336	302	407	363	487	420	560	523	688	756	962
	40	244	332	298	403	358	481	415	553	517	681	746	954	242	327	296	397	356	473	412	543	512	666	738	925	242	327	296	397	356	473	412	543	512	666	738	925
	45	238	323	291	391	350	467	405	536	504	658	728	916	236	318	289	385	347	458	401	525	499	641	719	883	236	318	289	385	347	458	401	525	499	641	719	883
	50	232	313	283	379	341	451	394	517	490	633	706	875	230	308	280	371	337	441	390	505	484	614	696	838	230	308	280	371	337	441	390	505	484	614	696	838
	55	224	301	274	364	329	433	381	496	474	604	681	829	222	296	271	356	326	422	376	482	467	584	670	788	222	296	271	356	326	422	376	482	467	584	670	788
	60	216	288	263	348	317	413	366	471	455	572	653	778	213	282	260	339	313	401	361	456	448	550	641	733	213	282	260	339	313	401	361	456	448	550	641	733
	65	206	273	251	329	302	390	349	444	433	537	621	721	203	267	248	320	298	377	344	428	426	512	608	673	203	267	248	320	298	377	344	428	426	512	608	673
	70	195	256	238	308	285	364	329	413	408	497	584	658	192	249	234	298	280	350	324	395	400	471	570	607	192	249	234	298	280	350	324	395	400	471	570	607
	75	182	237	222	284	266	334	307	378	380	451	541	587	179	229	218	273	261	319	300	359	371	423	526	532	179	229	218	273	261	319	300	359	371	423	526	532
	80	166	214	203	256	243	299	280	337	346	399	492	506	163	206	198	244	237	284	273	317	337	369	476	447	163	206	198	244	237	284	273	317	337	369	476	447
Après une petite alternance : asymétrie à l'instant du zéro de courant After minor loop : asymmetric at current zero	0	260	364	318	446	384	538	446	624	557	780	812	1137	260	364	318	446	384	538	446	624	557	780	812	1137	260	364	318	446	384	538	446	624	557	780	812	1137
	5	259	364	317	446	383	539	444	626	556	783	811	1146	259	364	318	447	383	540	445	627	556	785	812	1150	259	364	318	447	383	540	445	627	556	785	812	1150
	10	257	383	315	445	381	538	442	626	553	785	807	1153	258	364	316	446	381	540	443	628	554	789	809	1160	258	364	316	446	381	540	443	628	554	789	809	1160
	15	255	361	313	443	378	536	438	624	549	784	802	1157	256	362	313	445	379	539	440	628	550	790	805	1168	256	362	313	445	379	539	440	628	550	790	805	1168
	20	252	358	309	440	373	533	434	621	543	782	795	1158	253	360	310	443	375	537	435	626	545	789	798	1172	253	360	310	443	375	537	435	626	545	789	798	1172
	25	249	354	305	435	368	528	428	616	536	777	785	1156	250	356	306	439	370	533	430	622	539	786	790	1174	250	356	306	439	370	533	430	622	539	786	790	1174
	30	244	349	299	430	362	522	421	609	527	770	773	1150	245	352	301	434	364	528	423	617	531	781	779	1172	245	352	301	434	364	528	423	617	531	781	779	1172
	35	239	343	293	423	355	514	412	601	517	761	759	1142	240	346	295	428	357	521	415	610	521	774	766	1168	240	346	295	428	357	521	415	610	521	774	766	1168
	40	233	336	286	414	346	505	402	591	505	750	742	1130	235	340	288	420	349	513	406	601	509	764	750	1159	235	340	288	420	349	513	406	601	509	764	750	1159
	45	226	327	278	405	336	494	391	578	491	736	723	1114	228	332	280	411	339	502	395	590	496	752	732	1147	228	332	280	411	339	502	395	590	496	752	732	1147
	50	219	318	269	393	325	481	378	564	475	719	700	1094	221	323	271	401	328	490	382	576	481	737	710	1131	221	323	271	401	328	490	382	576	481	737	710	1131
	55	210	307	258	380	312	465	364	547	457	699	675	1070	212	313	261	388	316	476	368	561	463	720	686	1111	212	313	261	388	316	476	368	561	463	720	686	1111
	60	200	294	246	365	298	448	347	527	437	676	646	1041	203	301	249	374	302	460	352	542	444	698	658	1085	203	301	249	374	302	460	352	542	444	698	658	1085
	65	189	280	233	348	282	428	328	504	414	649	613	1007	192	287	236	358	286	441	334	521	421	673	626	1055	192	287	236	358	286	441	334	521	421	673	626	1055
	70	177	264	217	329	264	405	307	478	387	618	576	966	179	271	221	339	268	418	313	496	395	644	590	1017	179	271	221	339	268	418	313	496	395	644	590	1017
	75	162	245	200	306	243	378	283	448	357	581	533	917	165	252	204	317	248	393	289	467	366	609	548	972	165	252	204	317	248	393	289	467	366	609	548	972
	80	146	223	179	279	218	346	255	412	322	537	483	858	149	231	184	291	224	362	261	432	337	567	499	917	149	231	184	291	224	362	261	432	337	567	499	917

First pole to clear factor 1,3
Time constant of d.c. decrement 45 ms

Facteur de premier pôle: 1,3
Constante de temps de la composante continue: 45 ms

Tableau III/Table III

TTR après la coupure de courant asymétrique/TRV after breaking asymmetrical current

Fréquence / Frequency (Hz)		50												60											
Tension / Voltage (kV)		245		300		362		420		525		765		245		300		362		420		525		765	
Instant / Time co-ordinate (µs)		t ₁	t ₂	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂
		u _i	u _c	u _i	u _c	u _i	u _c	u _i	u _c	u _i	u _c	u _i	u _c	u _i	u _c	u _i	u _c	u _i	u _c	u _i	u _c	u _i	u _c	u _i	u _c
		Tension / Voltage (kV)																							
Après une grande alternance : asymétrie à l'instant du zéro de courant After major-loop : asymmetry at current zero	0	260	364	318	446	384	598	446	624	557	780	812	1137	260	364	318	446	384	538	446	624	557	780	812	1137
	5	260	363	318	444	384	535	445	620	554	773	809	1122	260	362	318	443	383	534	445	619	556	772	809	1119
	10	259	360	317	440	382	530	443	614	554	764	805	1104	259	359	317	439	382	528	443	612	553	761	804	1097
	15	257	357	315	436	380	524	440	606	550	753	798	1083	257	356	314	434	379	522	439	603	548	748	796	1073
	20	255	352	312	430	376	516	436	597	544	740	790	1060	255	351	311	428	375	513	435	593	543	734	787	1047
	25	252	347	308	423	372	508	431	586	537	725	779	1033	252	345	308	420	371	504	429	581	535	717	775	1017
	30	249	341	304	415	366	497	424	573	529	708	766	1003	248	339	303	412	365	493	423	567	527	698	761	983
	35	244	334	298	406	359	485	416	559	519	689	750	970	243	331	297	402	358	480	415	551	516	677	745	947
	40	239	325	292	395	352	472	407	542	507	667	732	934	238	322	291	390	350	466	405	534	504	654	727	907
	45	233	316	285	383	343	457	396	524	493	642	712	893	232	312	283	378	341	449	394	515	490	628	705	864
	50	226	305	276	369	332	439	384	504	478	615	688	849	225	301	275	363	330	431	382	493	474	599	681	816
	55	218	292	266	353	320	420	370	481	460	585	662	801	217	288	265	347	318	411	367	469	456	568	654	764
	60	209	279	255	336	307	399	354	455	440	552	631	747	208	274	253	329	304	389	351	442	436	533	623	708
	65	199	263	242	316	291	374	336	426	417	514	597	688	197	258	240	309	288	364	333	413	412	494	588	645
	70	187	245	228	294	273	347	316	394	391	473	559	622	185	240	226	286	271	336	312	379	386	450	549	576
	75	173	225	211	269	253	316	292	357	361	425	514	549	172	219	209	261	250	304	288	342	356	402	504	500
	80	157	202	191	240	229	280	261	315	327	371	463	466	156	195	189	231	226	268	260	299	321	346	452	413
Après une petite alternance : asymétrie à l'instant du zéro de courant After minor loop : asymmetric at current zero	0	260	364	318	446	384	538	446	624	557	780	812	1137	260	364	318	446	384	538	446	624	557	780	812	1137
	5	260	365	318	447	384	540	445	627	557	785	812	1149	260	365	318	448	384	541	446	628	557	787	813	1152
	10	259	364	317	447	382	541	444	628	555	788	811	1158	259	365	317	448	383	542	444	630	556	792	812	1185
	15	257	363	315	446	380	540	441	628	552	789	807	1165	257	364	315	448	381	542	442	631	554	794	809	1174
	20	254	361	312	444	377	538	438	626	548	789	802	1168	255	363	313	446	378	541	439	630	549	795	804	1181
	25	251	358	308	440	372	534	433	623	542	786	794	1168	252	360	309	443	373	538	434	628	544	794	797	1185
	30	248	354	304	436	367	529	426	618	534	780	784	1166	248	356	305	439	368	534	428	624	537	790	788	1185
	35	243	348	298	430	360	522	419	611	525	773	771	1160	244	351	299	434	362	528	421	618	528	784	776	1183
	40	238	342	292	422	353	514	410	602	515	763	756	1150	239	345	293	427	354	521	412	610	518	776	762	1177
	45	232	335	284	414	344	504	400	591	502	751	739	1137	233	338	286	419	346	511	402	600	505	765	745	1167
	50	224	326	276	403	333	492	388	578	487	736	718	1120	226	330	277	409	335	500	391	588	491	752	725	1153
	55	216	316	266	391	322	478	374	562	471	718	695	1098	218	320	267	397	324	487	377	573	475	736	703	1134
	60	207	304	254	377	308	462	359	544	452	697	668	1072	206	309	256	384	311	472	362	556	456	716	676	1111
	65	197	290	242	361	293	443	341	522	430	671	637	1040	198	295	244	368	296	454	345	536	435	692	646	1083
	70	185	275	227	347	275	421	321	497	405	642	601	1001	186	280	229	350	278	432	325	512	410	664	611	1047
	75	171	257	210	321	255	396	298	468	376	607	560	957	172	263	213	329	258	407	302	484	381	631	570	1004
	80	155	235	191	295	232	365	271	434	342	565	511	899	157	242	193	304	235	378	275	450	348	590	523	951

First pole to clear factor 1.3
Time constant of d.c. decrement 120 ms

Facteur de premier pôle: 1.3
Constante de temps de la composante continue: 120 ms